

# 国立研究開発法人産業技術総合研究所依頼試験規程

制定 平成16年11月1日 16規程第39号

(13規程第33号の全部改正)

最終改正 令和元年7月8日 令01規程第8号 一部改正

## 目次

- 第1章 総則（第1条・第2条）
- 第2章 鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正（第3条―第8条）
- 第3章 計量の標準に係る校正、試験等（第9条―第14条）
- 第4章 手数料（第15条）
- 第5章 雑則（第16条―第18条）
- 附則

### 第1章 総則

（趣旨）

**第1条** この規程は、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）が、国立研究開発法人産業技術総合研究所法（平成11年法律第203号）第11条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、依頼を受けて実施する試験、分析、校正等（以下「依頼試験」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

（依頼試験の種類、項目及び細目）

**第2条** 研究所が行う依頼試験の種類、項目及び細目は、次の各号に掲げる依頼試験の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める表中種類欄、項目欄又は細目欄にそれぞれ掲げるところによる。

- 一 鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正 別表1
- 二 計量の標準に係る校正、試験等 別表2

### 第2章 鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正

（申請）

**第3条** 依頼試験のうち、鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正を受けようとする者（以下この章において「申請者」という。）は、次に掲げるものを研究所に提出しなければならない。

- 一 鉱工業の科学技術に係る試験・分析・校正申請書（様式第1）
- 二 依頼試験用の試料、機械材料、装置、校正器物等（以下この章において「現品」という。）

2 研究所は、前項の申請を受けたときは、同項第1号の鉱工業の科学技術に係る試験・分析・校正申請書に別紙第1第1号に定める方法による番号を付す。

（研究所外での依頼試験）

**第4条** 研究所は、申請者が、前条第1項第2号の現品を提出することができないと認めると

きは、研究所以外の場所で依頼試験を行うものとする。この場合において、研究所は、これを行うのに要する研究所職員又は契約職員の旅費及び依頼試験に用いる試験用具の運搬に要する経費を次条に定める手数料に併せて請求するものとする。

(手数料)

**第5条** 研究所は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、申請者に、第4章の規定による手数料を納付期限を定めて請求する。ただし、理事長が手数料を減額又は免除することが適当であると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。

2 申請者は、前項の請求があったときは、研究所が指定する金融機関の預金口座に払い込まなければならない。ただし、研究所が特別な理由があると認めるときは、別の方法による払込みをすることができる。

(依頼試験の実施)

**第6条** 研究所は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、依頼試験を実施する。

(成績書又は校正証明書)

**第7条** 研究所は、依頼試験が終了したときは、申請者に対し、第4項に定める番号を付した成績書(様式第2)又は校正証明書(様式第3(英文の場合にあっては、様式第3-E))を交付し、現品を返還する(第4条に該当する場合を除く。)。ただし、研究所と申請者が合意したときには、現品を返還しない。

2 研究所は、やむを得ない事由により依頼試験を中止したときは、申請者に対し、第4項に定める番号を付した中止報告書(様式第4)を交付し、現品を返還する(第4条に該当する場合を除く。)。ただし、研究所と申請者が合意したときには、現品を返還しない。

3 研究所は、第1項の成績書又は校正証明書の記載内容等について修正が必要となったときは、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により修正を行うことができる。

一 成績書 新規の成績書又は成績書に関する追加文書(様式5)の交付

二 校正証明書 新規の校正証明書又は校正証明書に関する追加文書(様式6(英文の場合にあっては、様式6-E))の交付

4 第1項に規定する成績書、第2項に規定する中止報告書及び第3項に規定する成績書に関する新規文書又は追加文書の番号は別紙第1第1号に、第1項に規定する校正証明書及び第3項に規定する校正証明書に関する新規文書又は追加文書の番号は別紙第1第2号にそれぞれ定める方法により付す。

(受領書)

**第8条** 申請者は、前条第1項の規定により研究所から現品を受領したときは、現品返還受領書(様式第7)を研究所に提出しなければならない。

### 第3章 計量の標準に係る校正、試験等

(申請)

**第9条** 依頼試験のうち計量の標準に係る校正、試験等を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げるものを研究所に提出しなければならない。ただし、依頼試験のうち別表4に掲げる校正、試験等にあっては、第2号に掲げる計量器(器

物)の提出は不要とする。

- 一 計量の標準に係る校正・試験等申請書(様式第8)
- 二 依頼試験用の計量器(器物)
- 三 計量器(器物)確認書(様式第9)

2 前項ただし書きの場合において、研究所は、特に必要と認めるときは、同項第2号に掲げる計量器(器物)の提出を求めることができる。

3 研究所は、第1項の申請を受けたときは、同項第1号の計量の標準に係る校正・試験等申請書に受付け番号を付すものとする。

(計量器の確認)

**第10条** 研究所は、前条第1項第3号の確認書の提出を受けたときは、同項第2号の計量器(器物)について、受入れの可否を判断し、申請者の承諾を得るものとする。

(研究所外での依頼試験)

**第11条** 研究所は、前条の規定により受入れを可能と判断した場合であつて、申請者が、第9条第1項第2号の計量器(器物)を提出することができないと認めるときは、研究所以外の場所で依頼試験を行うものとする。この場合において、研究所は、これを行うのに要する研究所職員の旅費及び依頼試験に用いる検定用具の運搬に要する経費を次条に定める手数料に併せて請求するものとする。

(手数料)

**第12条** 研究所は、第9条第1項の規定による申請を受理したときは、申請者に、第4章の規定による手数料を納付期限を定めて請求する。ただし、理事長が手数料を減額又は免除することが適当であると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。

2 申請者は、前項の請求があつたときは、研究所が指定する金融機関の預金口座に払い込まなければならない。ただし、研究所が特別な理由があると認めるときは、別の方法による払込みをすることができる。

(依頼試験の実施)

**第13条** 研究所は、第9条第1項の規定による申請を受理したときは、依頼試験を実施する。

(校正証明書及び報告書等)

**第14条** 研究所は、依頼試験が終了したときは、申請者に対し、第4項に定める校正証明書番号を付した校正証明書(様式第10)又は試験(実施)報告書(様式第11)を交付し、計量器(器物)を返還する(第11条に該当する場合を除く。)

2 研究所は、やむを得ない事由により依頼試験を中止したときは申請者に対し、第4項に定める報告書番号を付した報告書(様式第12)を交付し、計量器(器物)を返還する(第11条に該当する場合を除く。)

3 研究所は、第1項の校正証明書又は試験(実施)報告書の記載内容等について修正が必要となったときは、再度新規の校正証明書若しくは試験(実施)報告書又は追加文書(様式第13)を交付することにより校正証明書の修正を行うことができる。

4 第1項に規定する校正証明書番号は別紙第1第3号(種類がOIML適合証明書である場合は、別紙第1第4号とする。)に、第2項に規定する報告書番号は別紙第1第5号に定める

表示方法により示すものとする。

- 5 第1項の規定にかかわらず、すでに発行したOIML適合証明書の修正申請（OIML-CS適合証明書を除く）に対する証明書は、追加文書（様式第13）を交付する。

#### 第4章 手数料

（手数料）

**第15条** 第5条第1項及び第12条第1項の手数料の額は、別表1又は別表2の表中種類欄、項目欄又は細目欄にそれぞれ掲げる依頼試験の種類、項目及び細目に応じ、次の各号により算定した経費の合計額（その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の額を加えた額とし、消費税等抜き額を依頼試験の種類、項目又は細目に応じ、別表1又は別表2の表中手数料欄に掲げる。

- 一 直接経費 依頼試験の遂行に直接必要な経費に相当する額（別表3に定める各経費の合計額をいう。）。この場合において、各経費の算定に用いる人件費及び光熱水料の各単価は、研究所が別に決定した単価を用いる。
- 二 間接経費 直接経費の15パーセント

#### 第5章 雑則

（代理人の選任）

**第16条** 申請者は、必要があると認めるときは、依頼試験に関する一切の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

- 2 前項の場合は、申請者は、研究所に委任状（様式第14）を提出しなければならない。

（所定外の依頼試験）

**第17条** 第2条の規定に関わらず、研究所は、別表1又は別表2に定める依頼試験の種類、項目又は細目以外の依頼試験であっても、次の各号に掲げる依頼試験の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める組織及びこれに関連する組織（この条において「担当組織等」という。）が協議して依頼試験を行うことが可能であると決定したときは、第3条第1項又は第9条第1項の規定による申請を受理することができる。この場合における手数料の額は、担当組織等が第4章の規定に準じて決定する。

- 一 鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正 知的財産・標準化推進部
- 二 計量の標準に係る校正、試験等 計量標準普及センター

（依頼試験の種類、項目等の見直し）

**第18条** 研究所は、依頼試験の種類、項目若しくは細目又は手数料を新設し、又は変更が必要となったときは、その都度、新設又は変更を行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、依頼試験の種類、項目及び細目並びに手数料について、平成16年4月1日を基準として3年毎に見直し（以下「定期見直し」という。）を行う。ただし、当該定期見直しの日の属する月の前3月内に行った依頼試験の新設又は変更については、最初の定期見直しは、行わないものとする。

附 則（16規程第39号・全部改正）

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(依頼試験実施要領等の廃止)

第2条 次に掲げる要領及び基準は、廃止する。

- 一 計量の標準に係る試験及び校正実施要領（13要領第121号）
- 二 依頼試験実施要領（15要領第67号）
- 三 依頼試験手数料算定基準（第75000-20040115-000号）

附 則（16規程第42号・一部改正）

この規程は、平成17年1月4日から施行する。

附 則（16規程第49号・一部改正）

この規程は、平成17年1月17日から施行する。

附 則（16規程第50号・一部改正）

この規程は、平成17年2月15日から施行する。

附 則（16規程第53号・一部改正）

この規程は、平成17年3月15日から施行する。

附 則（17規程第29号・一部改正）

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則（17規程第33号・一部改正）

この規程は、平成17年5月15日から施行する。

附 則（17規程第34号・一部改正）

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

附 則（17規程第39号・一部改正）

この規程は、平成17年6月15日から施行する。

附 則（17規程第50号・一部改正）

この規程は、平成17年7月15日から施行する。

附 則（17規程第51号・一部改正）

この規程は、平成17年8月15日から施行する。

附 則（17規程第62号・一部改正）

この規程は、平成17年9月15日から施行する。

附 則（17規程第70号・一部改正）

この規程は、平成17年10月15日から施行する。

附 則（17規程第74号・一部改正）

この規程は、平成17年11月15日から施行する。

附 則（17規程第81号・一部改正）

この規程は、平成17年12月15日から施行する。

附 則（17規程第86号・一部改正）

この規程は、平成18年1月15日から施行する。

附 則（17規程第91号・一部改正）

この規程は、平成18年2月15日から施行する。

附 則（17規程第94号・一部改正）

この規程は、平成18年3月15日から施行する。

附 則（18規程第10号・一部改正）

この規程は、平成18年4月15日から施行する。

附 則（18規程第16号・一部改正）

この規程は、平成18年5月12日から施行する。

附 則（18規程第31号・一部改正）

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

附 則（18規程第38号・一部改正）

この規程は、平成18年8月15日から施行する。

附 則（18規程第41号・一部改正）

この規程は、平成18年9月15日から施行する。

附 則（18規程第59号・一部改正）

この規程は、平成18年11月15日から施行する。

附 則（18規程第61号・一部改正）

この規程は、平成18年12月15日から施行する。

附 則（18規程第67号・一部改正）

この規程は、平成19年2月15日から施行する。

附 則（19規程第18号・一部改正）

この規程は、平成19年4月15日から施行する。

附 則（19規程第26号・一部改正）

この規程は、平成19年5月15日から施行する。

附 則（19規程第41号・一部改正）

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

附 則（19規程第51号・一部改正）

この規程は、平成20年2月15日から施行する。

附 則（19規程第53号・一部改正）

この規程は、平成20年3月15日から施行する。

附 則（20規程第20号・一部改正）

この規程は、平成20年4月15日から施行する。

附 則（20規程第30号・一部改正）

この規程は、平成20年8月15日から施行する。

附 則（20規程第48号・一部改正）

この規程は、平成20年10月15日から施行する。

附 則（20規程第53号・一部改正）

この規程は、平成21年2月15日から施行する。

附 則（20規程第57号・一部改正）

この規程は、平成21年3月15日から施行する。

附 則（21規程第11号・一部改正）

この規程は、平成21年5月15日から施行する。

附 則（21規程第24号・一部改正）

この規程は、平成21年6月15日から施行する。

附 則（21規程第26号・一部改正）

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

附 則（21規程第32号・一部改正）

この規程は、平成21年9月7日から施行する。

附 則（21規程第33号・一部改正）

この規程は、平成21年9月15日から施行する。

附 則（21規程第40号・一部改正）

この規程は、平成21年10月15日から施行する。

附 則（21規程第46号・一部改正）

この規程は、平成21年11月15日から施行する。

附 則（21規程第57号・一部改正）

この規程は、平成22年3月15日から施行する。

附 則（22規程第26号・一部改正）

この規程は、平成22年5月15日から施行する。

附 則（22規程第32号・一部改正）

この規程は、平成22年6月15日から施行する。

附 則（22規程第34号・一部改正）

この規程は、平成22年7月15日から施行する。

附 則（22規程第41号・一部改正）

この規程は、平成22年8月15日から施行する。

附 則（22規程第106号・一部改正）

この規程は、平成22年10月15日から施行する。

附 則（22規程第112号・一部改正）

この規程は、平成23年1月15日から施行する。

附 則（22規程第119号・一部改正）

この規程は、平成23年2月15日から施行する。

附 則（23規程第8号・一部改正）

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附 則（23規程第15号・一部改正）

この規程は、平成23年6月15日から施行する。

附 則（23規程第18号・一部改正）

この規程は、平成23年8月15日から施行する。

附 則（23規程第19号・一部改正）

この規程は、平成23年9月15日から施行する。

附 則（23規程第29号・一部改正）

この規程は、平成23年11月15日から施行する。

附 則（23規程第33号・一部改正）

この規程は、平成24年3月15日から施行する。

附 則（24規程第31号・一部改正）

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

附 則（24規程第32号・一部改正）

この規程は、平成24年5月15日から施行する。

附 則（24規程第34号・一部改正）

この規程は、平成24年6月15日から施行する。

附 則（24規程第37号・一部改正）

この規程は、平成24年9月15日から施行する。

附 則（24規程第57号・一部改正）

この規程は、平成24年11月15日から施行する。

附 則（24規程第58号・一部改正）

この規程は、平成25年1月15日から施行する。

附 則（24規程第64号・一部改正）

この規程は、平成25年3月15日から施行する。

附 則（25規程第15号・一部改正）

この規程は、平成25年4月15日から施行する。

附 則（25規程第20号・一部改正）

この規程は、平成25年5月15日から施行する。

附 則（25規程第21号・一部改正）

この規程は、平成25年5月16日から施行する。

附 則（25規程第26号・一部改正）

この規程は、平成25年7月15日から施行する。

附 則（25規程第27号・一部改正）

この規程は、平成25年9月15日から施行する。

附 則（25規程第58号・一部改正）

この規程は、平成25年10月15日から施行する。

附 則（25規程第59号・一部改正）

この規程は、平成25年11月15日から施行する。

附 則（25規程第62号・一部改正）

この規程は、平成26年2月15日から施行する。

附 則（26規程第6号・一部改正）

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則（26規程第34号・一部改正）



この規程は、平成26年5月15日から施行する。

附 則（26規程第35号・一部改正）

この規程は、平成26年6月15日から施行する。

附 則（26規程第66号・一部改正）

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

附 則（26規程第68号・一部改正）

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

附 則（26規程第71号・一部改正）

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（27規程第4号・一部改正）

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（27規程第62号・一部改正）

この規程は、平成27年6月15日から施行する。

附 則（27規程第64号・一部改正）

この規程は、平成27年8月6日から施行する。

附 則（27規程第65号・一部改正）

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

附 則（27規程第96号・一部改正）

この規程は、平成28年3月24日から施行する。

附 則（28規程第58号・一部改正）

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

附 則（28規程第59号・一部改正）

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

附 則（29規程第10号・一部改正）

この規程は、平成29年6月13日から施行する。

附 則（29規程第45号・一部改正）

この規程は、平成30年3月30日から施行する。

附 則（30規程第1号・一部改正）

この規程は、平成30年6月6日から施行する。

附 則（30規程第9号・一部改正）

この規程は、平成30年9月18日から施行する。

附 則（30規程第15号・一部改正）

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

附 則（30規程第18号・一部改正）

（施行期日）

**第1条** この規程は、平成30年12月15日から施行する。ただし、第14条の改正規定、別紙第1第4号の改正規定、附表第3号の改正規定、様式第2から第6、様式第8から第14の改正規定及び別表2-1第53の項の改正規定は、平成31年1月1日から適用する。

(研究所のロゴ及びOLML校正証明書番号に係る経過措置)

**第2条** 改正前の国立研究開発法人産業技術総合研究所依頼試験規程に規定する様式中の研究所のロゴについては、改正後の国立研究開発法人産業技術総合研究所依頼試験規程に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

2 第14条第5項の追加文書に用いる校正証明書番号は、なお従前の例による。

**附 則 (30規程第26号・一部改正)**

この規程は、平成31年2月15日から施行する。

**附 則 (令01規程第8号・一部改正)**

この規程は、令和元年7月15日から施行する。

## 別紙第1

### 第1号

産依頼試A-B号

ただし、Aは西暦で表した鉱工業の科学技術に係る試験、分析又は校正の申請を受け付けた年（以下「試験等年」という。）の末尾2桁のアラビア数字とし、Bは試験等年の試験、分析又は校正の数の通し番号とする。

ただし成績書修正のための新規文書又は追加文書発行の場合にはrDを付記し、Dは通し番号とする。

### 第2号

A-BC

ただし、Aは附表第1号の記号とし、Bは西暦で表した鉱工業の科学技術に係る校正に係る校正年の末尾2桁のアラビア数字とし、Cは校正年の校正の数の3桁の通し番号とする。

ただし校正証明書修正のための新規文書又は追加文書発行の場合にはrDを付記し、Dは通し番号とする。

### 第3号

ABC

ただし、Aは西暦で表した計量の標準に係る校正、試験等を行った年（以下「校正等年」という。）の末尾2桁のアラビア数字とし、Bは附表第2号の番号とし、Cは校正等年の校正、試験等の数の通し番号とする。

### 第4号

a/b-A-JP1-c. d

ただし、aは附表第3号のOIML国際勧告番号とし、bは同号のOIML国際勧告制定年とし、cは校正等年の末尾2桁のアラビア数字とし、dは校正等年の校正、試験等の数の通し番号とする。

### 第5号

第9条第3項の規定により付番した受付番号

附表

第1号

種類	記号
一次基準太陽電池セル	P

第2号

種類	番号
別表2-3に掲げるもの	1
別表2-2に掲げるもの	2
別表2-1に掲げるもの	3

第3号

種類	OIML国際勧告番号	OIML国際勧告制定年
質量計用ロードセル	R 60	2000
非自動はかり	R 76	1992、2006

様式第1

鉱工業の科学技術に係る試験・分析・校正申請書

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所

理事長 殿

(申請者)

所在地

機関名 (企業名等)

申請者名

印

(代理人)

所在地

機関名 (企業名等)

代理人名

印

下記のとおり試験・分析・校正を申請します。

1. 品名及び数量

2. 産地又は製造地及び製造者

3. 試験・分析・校正のNo. と種類、項目及び細目

4. 手数料

円

5. 産総研外で実施する場合：

試験・分析・校正を受けようとする場所・日程

6. その他必要事項

・担当者連絡先

(以下は産総研が記入)

申請書受付日： 年 月 日 受付番号：産依頼試



成績書

産依頼試

年 月 日

殿

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 印

品名及び数量

試験・分析事項

年 月 日付で申請者から当所に提出された上記現品の  
試験・分析結果は下記のとおりである。

記



(Format No.3-E)

(第三者機関により校正機関としての適合性認定を受けている場合は、ここに対応するロゴマークを付加する。該当しない場合、この記述を削除する。)



Certificate No. P-YYZZZ-E

Date of Issue: Month.DD,YYYY

## Calibration Certificate

**Calibrated Device:**

Device Name

Manufacturer

Type and Serial Number

**Applicant:**

Name

Address

Date of Application

Calibration Method

Calibration Conditions:

**Calibration Site**

Date of Calibration

Month.DD,YYYY - Month.DD,YYYY

**Calibration Results**

Short-circuit Current mA

Expanded Uncertainty mA

(Coverage factor  $k=2$ , Level of approximately 95 % confidence)**Calibration Authority**

署名

校正責任者

Department of Energy and Environment Research Center for Photovoltaics

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

**Issuing Authority**

理事長

印

**President**

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Note

AIST Receipt No.





産依頼試

年 月 日

## 中止報告書

年 月 日にご依頼がありました、受付番号：産依頼試 の鉦工業の科学技術に係る試験、分析又は校正は以下の理由により中止しましたのでご報告いたします。

品名及び数量

申請者名

申請者住所

中止理由

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 印

様式第5

産依頼試

年 月 日



成績書に関する追加文書

殿

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 印

年 月 日発行の成績書(産依頼試 )の記載内容  
を、以下のように修正します。(総頁数 頁)

(正)

(誤)

様式第6

(文書番号)

年 月 日



校正証明書に関する追加文書

殿

年 月 日発行の校正証明書( )の記載内容を、以下のように修正します。(総頁数 頁)

(正)

(誤)

発行者  
東京都千代田区霞が関一丁目3番1号  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 印

---

(備考)

受付番号：産依頼試

(Format No6-E)

(第三者機関により校正機関としての適合性認定を受けている場合は、ここに対応するロゴマークを付加する。該当しない場合、この記述を削除する。)



Certificate No.

Date of Issue: Month, DD, YYYY

## Calibration Certificate Corrigenda

To Name

Issuer

President

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

This corrigenda has been issued to correct errors in the calibration certificate No. , issued on Month, DD, YYYY, as follows

In “\*\*\*\*\*” on page ## of the original Certificate,

Corrected:

Original (incorrect :the corrected part is underlined)

The Calibration Authority

署名

校正責任者名

Department of Energy and Environment Research Center for Photovoltaics

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

---

Note

AIST Receipt No.

様式第7

現品返還受領書

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 殿

年 月 日付け鉦工業の科学技術に係る試験・分析・校正申請書により提出いたしました現品を返還していただき、確かに受領いたしました。

年 月 日

住 所

機関名

氏 名

印



計量の標準に係る校正・試験等申請書

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 殿

(申請者)

名 称

住 所

(上記が証明書の発行先になります)

(代理人)

名 称

住 所

計量標準に係る校正・試験等を申請します。

1 校正を受けようとする標準物質の内容

校正・試験等の種類

標準物質の名称及び数量

標準物質の製造者名

型式及び製造番号 (識別番号)

校正点

2 校正を受けようとする場所

3 証明書等

和文 通

英文 通

4 手数料

円

5 その他 担当者名及び連絡先

T E L :

F A X :

E-mail:

(備考)

英文証明書の発行を希望場合は、申請者欄、項目 1 (校正・試験の種類を除く) 及び項目 2 を英文で記載するか又は英文の別紙を添付すること。

計量の標準に係る校正・試験等申請書

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 殿

(申請者)

名 称

住 所

(上記が証明書の発行先になります)

(代理人)

名 称

住 所

計量標準に係る校正・試験等を申請します。

1 校正を受けようとする器物の内容

校正・試験等の種類

計量器（器物）の名称及び数量

計量器の製造者名

型式及び器物番号（識別番号）

校正点

2 校正を受けようとする場所

3 証明書等

和文

通

英文

通

4 非重複宣言

他の機関において既に0IML適合証明書の申請を行っているか ( はい、 いいえ )

5 手数料

円

6 その他 担当者名及び連絡先

T E L :

F A X :

E-mail:



計量器（器物）確認書

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 殿

計量器（器物）の名称及び数量 台

計量器の製造者名

型式及び器物番号

計量器の確認

計量器の基本的事項の確認により、受入可能と判断しました。

状態に関する特記事項

計量器の基本的事項の確認により、受入不可能と判断しました。

上記のとおり、計量器の確認をいたしました。

校正担当確認者  
申請担当者



校正証明書

依頼者名

依頼者住所

校正実施場所

特定副標準器名

製造者名

型式・器物番号

校正方法

校正実施条件

校正結果

受付年月日

年 月 日

校正実施年月日

年 月 日 ～ 年 月 日

以上に相違ないことを証明する

校正責任者

計量標準総合センター

署名

校正責任者名

発行日 年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



校正証明書

依頼者名

依頼者住所

校正実施場所

計量器名

製造者名

型式・器物番号

校正方法

校正実施条件

校正結果

受付年月日

年 月 日

校正実施年月日

年 月 日 ~

年 月 日

以上に相違ないことを証明する

校正責任者

計量標準総合センター

署名

校正責任者名

発行日

年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



校正証明書

依頼者名

依頼者住所

校正実施場所

標準物質名

製造者名

型式・製造番号

校正方法

校正実施条件

校正結果

受付年月日

年 月 日

校正実施年月日

年 月 日 ～ 年 月 日

以上に相違ないことを証明する

校正責任者

計量標準総合センター

署名

校正責任者名

発行日 年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号



国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



	
<p><b>OIML Member State</b> Japan</p>	<p><b>OIML Certificate No.</b> R / -JP1-</p>
<p>OIML CERTIFICATE ISSUED UNDER SCHEME A</p>	
<p><b>OIML Issuing Authority</b></p> <p>Name: National Metrology Institute of Japan /National institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST)</p> <p>Address: AIST Tsukuba Central 3-9, Tsukuba Ibaraki 305-8563, Japan</p> <p>Person responsible: President of AIST</p>	
<p><b>Applicant</b></p> <p>Name: .....</p> <p>Address: .....</p>	
<p><b>Manufacturer</b></p> <p>Name: .....</p> <p>Address: .....</p>	
<p><b>Identification of the certified type</b> <i>(the detailed characteristics will be defined in the additional pages)</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p><b>Designation of the module</b> <i>(if applicable)</i></p> <p>.....</p>	
<p>This OIML Certificate attests the conformity of the above identified type (represented by the sample(s) identified in the OIML type evaluation report) with the requirements of the following Recommendation of the International Organization of Legal Metrology (OIML):</p> <p>OIML R ..... Edition (year): .....</p> <p>For accuracy class (if applicable): .....</p>	

This OIML Certificate relates only to metrological and technical characteristics of the type of measuring instrument covered by the relevant OIML Recommendation identified above.

This OIML Certificate does not bestow any form of legal international approval.

The conformity was established by the results of tests and examinations provided in the associated OIML type evaluation report:

No. .... dated ..... that includes ..... pages

The technical documentation relating to the identified type is contained in documentation file:

No. .... dated ..... that includes ..... pages

**OIML Certificate History**

Revision No.	Date	Description of the modification

Identification, signature and stamp

**The CIML Member**

**The Issuing Authority**

NMIJ/AIST



署名

Dr.

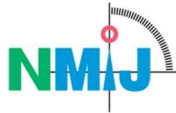
(CIML委員名)

President of AIST

- - (Date)

- - (Date)

Important note: Apart from the mention of the Certificate's reference number and the name of the OIML Member State in which the Certificate is issued, partial quotation of the Certificate and of the associated OIML type evaluation report(s) is not permitted, although either may be reproduced in full.



不適合理由通知書

年 月 日

殿

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
計量標準総合センター

年 月 日付でOIML証明書の申請のあった計量器については、OIML国際勧告 R.....（ 年版）の要求事項に基づき試験を行った結果、下記の理由により不適合となったので、OIML B3「OIML証明書制度」3.4.5 b)の規定に基づき通知します。

申請した計量器の種類：

不適合の理由：





OIML Nonconformity Notification

Issuing Authority

Name: National Metrology Institute of Japan/National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST)

Address: AIST Tsukuba Central 3-9, Tsukuba Ibaraki 305-8563, Japan

Person responsible: President of AIST

Applicant

Name:

Address:

Identification of the applied type of measuring instruments:

This is, in accordance with 3.4.5 b) of OIML B3 "OIML Certificate System for Measuring Instruments", to notify that the above type applied on the date of ..... has failed to be in conformity to the requirements of OIML Recommendation R....., Edition (Year)..... due to the following reason.

Reason for nonconformity:

The Issuing Authority

NMIJ/AIST

Date:



試験報告書

依頼者名

依頼者住所

試験実施場所

計量器名

製造者名

型式・器物番号

試験方法

試験実施条件

試験結果

受付年月日

年 月 日

試験実施年月日

年 月 日 ～ 年 月 日

以上に相違ないことを証明する

試験責任者

計量標準総合センター

署名

試験責任者名

発行日

年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



試験実施報告書

依頼者名

依頼者住所

試験実施場所

計量器名

製造者名

型式・器物番号

試験方法

試験実施条件

受付年月日

年 月 日

試験実施年月日

年 月 日 ~ 年 月 日

以上に相違ないことを証明する

試験責任者

計量標準総合センター

署名

試験責任者名

発行日 年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



## 報告書

年 月 日 付けにてご依頼がありました、「依頼計量器名」の校正（試験）につきまして、以下の理由により、校正（試験）を中止しましたので、ご報告いたします。

※以下、試験の場合は、「校正」を「試験」に変更

依頼者名

依頼者住所

校正実施場所

計量器名

製造者名

型式・器物番号

校正方法

中止理由

校正責任者

計量標準総合センター

署名（サイン）

校正責任者名（タイプ）

発行日

年 月 日

発行者

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

理事長

印



## Report

This is to report that the requested calibration (test) was discontinued due to the reason described below.

※以下、testの場合は、“Calibration”を“Test”に変更

Client Name:

Client Address:

Calibration Site(s):

Calibration Item(s):

Manufacturer:

Type and Serial Number:

Date of Application:

Calibration Method:

Reasons for Discontinuance:

The Calibration Authority

署名 (サイン)

校正責任者名 (タイプ)

National Metrology Institute of Japan

Date of Issue:

The Issuing Authority

理事長

印

President,

National Institute of Advanced Industrial Science and  
Technology

1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan



年 月 日  
第 号

(校正証明書) に関する追加文書  
(試験 (実施) 報告書) に関する追加文書

殿

東京都千代田区霞が関一丁目3番1号  
国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 印




年 月 日発行の校正証明書第  
ます。(総頁数 頁)





号の記載内容を、以下のように修正し

(正)

(誤)

校正責任者  
計量標準総合センター  
署名

	
<b>OIML Member State</b> Japan	<b>OIML Certificate No.</b> R / -JP1-
<b>ANNEX to an OIML Certificate of Conformity</b>	
<b>OIML Issuing Authority</b> Name: National Metrology Institute of Japan /National institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST) Address: AIST Tsukuba Central 3-9, Tsukuba Ibaraki 305-8563, Japan Person responsible: President of AIST	
<b>Applicant</b> Name: ..... Address: .....	
<b>Manufacturer</b> Name: ..... Address: .....	
<b>Correction</b> ..... .....	
Identification, signature and stamp <b>The Issuing Authority</b> NMIJ/AIST <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> President of AIST - - (Date)	<b>The CIML Member</b> 署名 Dr. (CIML委員名) - - (Date)

	 
<b>OIML Member State</b> Japan	<b>OIML Certificate No.</b> R / -JP1-
<b>ANNEX to an OIML Certificate of Conformity</b>	
<b>OIML Issuing Authority</b> Name: National Metrology Institute of Japan /National institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST) Address: AIST Tsukuba Central 3-9, Tsukuba Ibaraki 305-8563, Japan Person responsible: President of AIST	
<b>Applicant</b> Name: ..... Address: .....	
<b>Manufacturer</b> Name: ..... Address: .....	
<b>Correction</b> ..... .....	
Identification, signature and stamp <b>The Issuing Authority</b> NMIJ/AIST <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> President of AIST - - (Date)	<b>The CIML Member</b> 署名 Dr. (CIML委員名) - - (Date)



委任状

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長 殿

弊社は、

を代理人と定め、依頼試験に関する一切のことを委任します。

委任者 住所（居所）

委任者 氏名（名称）

印

受任者 住所（居所）

受任者 氏名（名称）

印

別表1 鋁工業の科学技術に係る試験、分析又は校正

●手数料額(消費税等抜き)は別表1内手数料の額に成績書又は校正証明書手数料を加えた額になります。

成績書又は校正証明書手数料

和文 1部につき 1,300 円(正本・複本とも同じ)

英文 1部につき 2,300 円(正本・複本とも同じ)

No.	種類	項目	細目	手数料(基本料金)(円)	
1	材料及び製品の試験	火薬類の試験	特殊な試験(例:高速カメラ使用)	1試験につき	219,200
2			簡単な試験(定型化した試験方法による試験)	1試験につき	66,000
3			圧力容器試験	1試験につき	150,400
4			爆速試験(JIS 試験法)	1試験につき	129,300
5			爆速試験	1試験につき	129,300
6			鉄管試験	1試験につき	126,000
7			落槌感度試験	1試験につき	37,700
8			摩擦感度試験	1試験につき	57,500
9			水中爆力試験	1試験につき	113,900
10			応用試験(複数の試験方法を組み合わせる試験)	1件につき	1,015,500
11			自動車用緊急保安炎筒試験(水分、燃焼時間、光度試験をJIS D5711-2004 に準じて行う)	1試験につき	135,500
12			漂白剤の不安定性物質生成に関する評価試験	1試験につき	64,000
13	糖鎖分析	定量的糖鎖結合特異性評価	フロンタル・アフィニティークロマトグラフィー分析	1試験につき	195,300
14	基準太陽電池セルの校正	一次基準太陽電池セルの校正	直流電流:10 mA 以上 200 mA 以下	1台につき	785,100

別表 2-1 計量の標準に係る校正、試験等

●依頼試験手数料の額（消費税等抜き）は、別表 2-1 内手数料の額に校正証明書手数料の額を加えた額になります。

校正証明書手数料

和文 1部につき 1,300円（正本・複本とも同じ）

英文 1部につき 2,300円（正本・複本とも同じ）

No.	種類	項目	細目	手数料（基本料金）（円）		備考
1	長さ	ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	32,800	
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	48,500	
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	95,400	
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,400	
		ブロックゲージ(遠隔校正)	呼び寸法が0.5 mm以上100 mm以下のもの	1個につき	73,700	
		低熱膨張係数ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	32,800	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	48,500	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	95,400	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,400	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
		段差高さ	ブロックゲージ対(それぞれのブロックゲージの呼び寸法は 0.5 mm以上 100 mm以下、呼び寸法の差は $-10 \mu\text{m}$ 以上 $10 \mu\text{m}$ 以下の範囲)	1対につき	61,100	基本の1対のうちの1本を基準として、ブロックゲージが1本増す毎に28,900円を加算する。呼び寸法が30 mm未満の場合8本まで、30 mm以上50 mm未満の場合4本まで、50 mm以上の場合1本のみ追加可能。
			段差高さゲージ	1個4段差まで	70,700	1段差を追加する毎に3,100円を加算する。
		標準尺絶対測定(指定線間)	普通精度(精度が $2 \mu\text{m}$ 又はそれより低いもの)	1個につき	207,200	
			高精度(精度が $0.5 \mu\text{m}$ 又はそれより低いもの)	1個につき	341,600	
		距離計	光波距離計(校正範囲5 m以上200 m以下)	距離計本体・反射鏡1組につき	289,800	反射鏡を1個追加する毎に101,600円を加算する。
		干渉測長器	校正範囲1 m以上100 m以下	1個10箇所まで	167,500	
		固体屈折率	BK7又は同等品(真空中波長632.99 nmにおいて屈折率が1.51以上1.52以下)	1個3測定箇所につき	222,200	1測定箇所を追加する毎に49,200円を加算する。
			BK7又は同等品(真空中波長546.2 nmにおいて屈折率が1.51以上1.53以下)	1個3測定箇所につき	207,400	1測定箇所を追加する毎に54,000円を加算する。
2	幾何学量	触針式段差・深さ		1個につき	276,400	
		ボールプレート・ホールプレート	レーザ干渉測定 560 mm以下	1個につき	256,900	
			参照標準との比較測定 700 mm以下	1個につき	211,700	

ステップゲージ	1 020 mm以下	1個につき	236,100	
ボールバー	レーザ干渉測定 720 mm以下	1個につき	227,000	
	参照標準との比較測定 1 020 mm以下	1個につき	105,500	
一次元グレーティング	23 nm以上8 μm以下	1個につき	330,400	
二次元グレーティング	100 nm以上8 μm以下	1個につき	535,800	
二次元グリッド	マーク中心座標 350 mm × 350 mm まで	1個100測定箇所につき	374,200	1測定箇所を追加するごとに2,700円を追加する。
線幅(パターン寸法)	30 nm 以上0.5 μm 以下	1個につき	417,500	試料外形 105 mm × 105 mm × 10 mm 以下
オートコレメータ	最大校正範囲±5° 校正点数約200 点	1個1軸	188,500	2軸目を校正する場合は、134,300円を加算する。
線幅フォトマスク	500 nm以上 10 μm以下	1個につき	342,300	1校正線を追加するごとに152,300円を加算する。
CTによる幾何形状測定	10 mm以上200 mm以下	1項目につき		形状等により別途見積
CMMによる幾何形状測定		1項目につき		形状等により別途見積
CMM(遠隔校正)	測定長さ 1 m以下	1個につき	232,600	
光学式段差測定	0.02 μm以上0.5 μm以下	1個につき	259,800	
ロータリーエンコーダ		1個につき	231,000	
多面鏡	6面以下	1個につき	131,400	
	7面以上24面以下	1個につき	143,000	
	25面以上48面以下	1個につき	189,300	
表面粗さ測定	粗さ用標準片	1個につき	286,100	
平面度	平面度:参照オプティカルフラットによる比較測定 300 mm(12インチ)以下、形状データの添付をしない場合	1個1面につき	171,500	1校正面を追加する毎に 34,700円を加算する。
	平面度:参照オプティカルフラットによる比較測定 300 mm(12インチ)以下、形状データをCD-ROMで添付する場合	1個1面につき	221,200	1校正面を追加する毎に 47,100円を加算する。
	真直度:形状測定機による一次元形状の校正 50 mm 以上500 mm 未満	1個1ラインにつき	278,800	1ラインを追加する毎に51,800円を加算する。
	真直度:形状測定機による一次元形状の校正 500 mm 以上1 050 mm 以下	1個1ラインにつき	322,300	1ラインを追加する毎に 61,100円を加算する。
球面度	基準球面との比較の場合	1個につき	165,000	
	二球面比較法による絶対測定の場合	1個あるいは一対につき	314,200	
AFM方式段差測定		1個につき	345,300	
AFM 式表面粗さ測定	算術平均粗さRa : 1 nm 以上50 nm 以下	1個につき	330,200	試料外形 20 mm x 20 mm x 4 mm 以下
真円度	直径の呼び寸法が100 mm以下の回転精度検査用標準器 範囲0 mm以上100 mm以下のもの	1個につき	105,000	

		真円度測定機用倍率校正器	切欠き量の呼び寸法2 $\mu\text{m}$ 以上500 $\mu\text{m}$ 以下, 直径の呼び寸法2 mm 以上90 mm 以下	1個につき	214,200	
		小径内径(最小二乗直径)	直径の呼び寸法 0.5 mm 以上2 mm 以下	1個につき	175,800	
		歯形	基礎円直径: 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき(1 測定ライン含 む)	295,400	1測定ラインを追加する毎に9,700円を加算す る。
		歯すじ	基準円直径: 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき(1 測定ライン含 む)	295,400	1測定ラインを追加する毎に9,700円を加算す る。
		歯車ピッチ	基準円直径: 60 mm 以上300 mm 以下	1個につき	285,000	
3	時間	周波数(遠隔校正)	周波数:5 MHz, 10 MHz	1年間12回に つき	165,200	初期設置調整時に申請者側使用場所にて 動作確認が必要となった場合、研究所職員 の出張に係る実費を加算する。
				初期設置調整 手数料(初回 のみ)	66,300	初期設置座標測定を希望される場合は、手 数料として80,300円と研究所職員の出張に 係る実費を加算する。
4	質量	分銅又はおもり	校正範囲が1 mg以上 100 g未満のもの	1試料につき	60,700	比較測定については60,700円を加算する。
			校正範囲が100 g以上20 kg以下のもの	1試料につき	92,200	比較測定については92,200円を加算する。
		校正範囲が 20 kgを超え 1 050 kg以 下のもの	相対拡張不確かさが15 ppm以下	1試料につき	149,400	質量調整のある場合は149,400円を加算す る。
			相対拡張不確かさが15 ppmを超えるもの	1試料につき	74,900	質量調整のある場合は74,900円を加算する。
			校正範囲が1 050 kgを超え5 200 kg以下のもの	1個につき	287,300	質量調整のある場合は287,300円を加算す る。
		特性試験	分銅の体積・磁化率及び表面粗さ	1個につき	54,600	
5	力	高精度力計	最大荷重が 1 MN以下のもの	1個につき	194,300	1試験項目を追加する毎に194,300円を加算 する。
			最大荷重が 1 MNを超えるもの	1個につき	466,600	1試験項目を追加する毎に基本料金の 466,600円を加算する。
6	トルク	トルクメータ	校正範囲が0.01 N・m 以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	136,000	左右ねじりの場合、103,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,400円 を加算する(但し最大10ステップ)。
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	153,200	左右ねじりの場合、135,600円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に17,500円 を加算する(但し最大10ステップ)。
			校正範囲が 200 N・m以上、20 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	204,500	左右ねじりの場合、161,800円を加算する。校 正ステップを1ステップ増す毎に21,300円を 加算する(但し最大10ステップ)。
		参照用トルクレンチ	校正範囲が 0.1 N・m 以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	136,000	左右ねじりの場合、103,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,400円 を加算する(但し最大10ステップ)。
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	153,200	左右ねじりの場合、135,600円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に17,500円 を加算する(但し最大10ステップ)。
			校正範囲が 200 N・m以上、5 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	204,500	左右ねじりの場合、158,500円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に 21,300円 を加算する(但し最大10ステップ)。
7	圧力	気体	ゲージ圧力 5 kPa以上100 MPa以下	1台につき(校 正圧力点5点 以下)	217,400	校正圧力点が6点以上の場合1点につき 43,400円を加算する。

			絶対圧力 5 kPa以上7 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	331,100	校正圧力点が6点以上の場合1点につき66,100円を加算する。 真空排気による絶対圧力校正。
			絶対圧力110 kPa以上100 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	217,400	校正圧力点が6点以上の場合1点につき43,400円を加算する。 大気圧計を使用した絶対圧力校正。
			差圧1 Pa以上10 kPa以下 (ライン圧力100 kPa±10 kPa)	1台につき(校正圧力点4点以下)	368,300	校正圧力点が5点以上の場合1点につき73,600円を加算する。
			絶対圧力10 Pa以上10 kPa以下	1台につき(校正圧力点4点以下)	368,300	校正圧力点が5点以上の場合1点につき73,600円を加算する。
			遠隔校正 大気圧 (絶対圧力 95 kPa以上 105 kPa以下)	1台につき	196,200	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
			遠隔校正 差圧10 Pa以上10 kPa以下 (ライン圧力 大気圧)	1台につき(校正圧力点7点以下)	284,500	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
	液体		1 MPa以上500 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	216,200	校正圧力点が6点以上の場合1点につき43,100円を加算する。
			100 MPa以上1 GPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	259,300	校正圧力点が6点以上の場合1点につき51,800円を加算する。
			遠隔校正 圧力10 MPa以上 100 MPa以下	1台につき(校正圧力点10点以下)	260,500	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
8	重力加速度	絶対重力計		1台につき	749,900	
9	真空	真空計	粘性(スピニングローター)真空計(0.1 mPa以上10 Pa以下のもの)	1個1校正点につき	281,500	GPIB、RS232Cインターフェースで制御可能なスピニングローター真空計であること 代表点として0.1 Paにおいて校正を実施し、校正点数を増やす場合は1点につき140,900円を加算する。
			隔膜真空計(0.1 Pa以上150 Pa以下のもの)	1個3校正点につき	249,500	GPIB、RS232Cインターフェースを有すること。 3校正点数を追加する毎に20,300円を加算する。
			電離真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下	1個につき	287,300	
			電離真空計 $1 \times 10^{-9}$ Pa 以上 $2 \times 10^{-6}$ Pa以下	1個につき	374,600	校正ガスを窒素とする。金属ガスケットで真空装置に接続できる真空計に限る。
			分圧真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下 (N <sub>2</sub> ,Ar,He,H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつき	320,300	追加ガスを1種追加する毎に98,500円を加算する。
	リーク		標準リーク $1 \times 10^{-10}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-6}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	262,900	真空へのリーク量(ヘリウム)
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつき	232,200	真空へのリーク量(ヘリウム、アルゴン) 校正点1点追加につき、55,300円を加算する。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	148,300	大気中へのリーク量(窒素) 校正点1点追加につき、32,800円を加算する。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつき	202,000	大気中へのリーク量(ヘリウム、R134a、水素5%+窒素95%混合ガス、アルゴン) 校正点1点追加につき、50,300円を加算する。

		標準コンダクタンス	標準コンダクタンスエレメント N <sub>2</sub> に対して、 $1 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{s}$ 以上 $1 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}$ 以下(追加ガスとして、Ar,He,H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつき	81,200	一次圧力を $10^2 \text{ Pa}$ 以上 $10^5 \text{ Pa}$ 以下で、コンダクタンスの圧力依存性が3 %以下である圧力範囲で測定。真空対応の接続配管を有し、ガス放出の小さいもの(二次圧力の到達圧力 $10^{-6} \text{ Pa}$ 以下)。追加ガスを1種追加することにより、66,200円を加算する。
10	流量	気体小流量	音速ノズル(衡量法)(口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類につき	765,100	
			音速ノズル(比較法)(口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類につき	449,400	
			気体小流量用流量計(比較法)	1台気体1種類につき	449,400	
			気体小流量用流量計(PVTt法)	1台気体1種類につき	463,400	
		気体中流量	気体用流量計(閉ループ法)	1個1圧力5流量につき	239,400	1圧力を追加する毎に215,600円を加算する。同一圧力で5流量を超える場合は1流量毎に24,000円を加算する。
		気体中流速	超音波流速計等(1.3 m/s以上40 m/s以下)	1個10流速につき	290,000	1流速を追加する毎に57,900円を加算する。
			レーザ流速計(1.3 m/s 以上40 m/s 以下)	1個につき	329,800	
		気体大流速	ピトー管(40 m/s 以上90 m/s 以下)	1個6流速につき	319,700	ピトー管の取り付け及び取り外し、並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。6流速を超え1流速増す毎に、33,600円を加算する。
		液体小流量	水用流量計(口径25 mm以下)	1個5流量につき	296,200	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に38,000円を加算する。
		液体大流量及び中流量	水用流量計(口径15 mm以上50 mm未満)	1個5流量につき	385,800	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に42,300円を加算する。
			水用流量計(口径50 mm以上175 mm以下)	1個5流量につき	473,700	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に56,600円を加算する。
			水用流量計(口径175 mmを超え400 mm以下)	1個5流量につき	708,700	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に78,700円を加算する。
			水用流量計(口径400 mmを超え600 mm以下)	1個5流量1温度につき	3,774,500	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に190,800円を加算する。1校正温度点を追加する毎に843,200円を加算する。

		石油小流量(軽油・灯油)	範囲:0.02 L/h 以上 100 L/h 以下 4.4×10 <sup>-6</sup> kg/s 以上 2.2×10 <sup>-2</sup> kg/s 以下		1個3流量につ き	295,000	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形 状の配管等を使用する場合に必要な費用は 含まない。 1流量を追加する毎に45,800円を加算する。 1校正温度を追加する毎に59,400円を加算 する。 1校正試験液を追加する毎に85,800円を加 算する。
		石油中流量(軽油・灯油・低粘度工 業用潤滑油(スピンドル油))・工業ガ ソリン	範囲:0.1 m <sup>3</sup> /h以上15 m <sup>3</sup> /h以下、0.022 kg/s以上3.4 kg/s以下		1個3流量につ き	274,700	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形 状の配管等を使用する場合に必要な費用は 含まない。 1流量を追加する毎に34,000円を加算する。 1校正温度を追加する毎に71,200円を加算 する。 1校正試験液を追加する毎に145,800円を加 算する。
		石油大流量(軽油・灯油)	範囲:3 m <sup>3</sup> /h以上300 m <sup>3</sup> /h以下、0.67 kg/s以上67 kg/s以下		1個3流量につ き	1,385,100	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形 状の配管等を使用する場合に必要な費用は 含まない。 1流量を追加する毎に347,900円を加算する。 1校正温度を追加する毎に173,800円を加算 する。 1校正試験液を追加する毎に347,900円を加 算する。
11	密度	シリコン単結晶	圧力浮遊法による密度差校正 密度差:0 kg/m <sup>3</sup> 以上0.035 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量:5 g以上1 010 g以下		1個につき	233,900	
		固体材料	液中ひょう量法による固体密度測定 密度:800 kg/m <sup>3</sup> 以上20 000 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量:30 g以上1 010 g以下		1個につき	248,100	
		PVT性質	作動流体, 圧力0 MPa~20 MPa, 密度 0 kg m <sup>-3</sup> ~1 700 kg m <sup>-3</sup> , 温度 260 K ~423.15 K		1温度1圧力につ き	97,900	同一温度の場合, 追加1点につき 18,200 円 を加算する。
		密度標準液	水溶液 温度20℃,密度998 kg/m <sup>3</sup> ~1 050 kg/m <sup>3</sup>		1試料につき	161,000	
12	粘度・動粘度	粘度標準液	動粘度	-40 ℃ ~ 100 ℃ (20 ℃ ~ 40 ℃を除く)	使用細管粘度 計1種類1指定 温度につき	101,700	使用細管粘度計が同一の場合において、1 指定温度を追加する毎に34,400円を加算す る。
			粘度	-40 ℃ ~ 100 ℃ (20 ℃ ~ 40 ℃を除く)	使用細管粘度 計1種類1指定 温度につき	152,000	使用細管粘度計が同一の場合において、1 指定温度を追加する毎に55,300円を加算す る。
		非ニュートン性液体	ずり応力	2×10 <sup>-3</sup> Pa以上34 Pa以下	1個ずり速度3 点につき	202,700	ずり速度を1点追加する毎に18,900円を加算 する。
13	体積 (衡量法)	タンク	容量10 L		1個1目盛につ き	103,400	校正する目盛を1カ所追加する毎に51,700円 を加算する。
			容量50 L以上100 L以下		1個1目盛につ き	153,900	校正する目盛を1カ所追加する毎に76,900円 を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につ き	216,300	校正する目盛を1カ所追加する毎に108,100 円を加算する。
		ビュレット(出用)	2 L以下のもの		1個3箇所まで	75,300	校正する目盛を1カ所追加する毎に7,000円 を加算する。
		フラスコ(出用)	全量1 L以上10 L以下		1個につき	71,300	
14	音響	音場感度(計測用マイクロホン)	I形20 Hz以上12.5 kHz以下、II形20 Hz以上20 kHz以下、WS3形20 Hz 以上20 kHz 以下		1個1校正周波 数につき	74,800	1校正周波数を追加する毎に2,200円を加算 する。



			WS3形 20 kHz以上100 kHz以下	1個1校正周波数につき	109,400	1校正周波数を追加する毎に18,400円を加算する。
		音圧感度(計測用マイクロホン)	I形(1 Hz以上20 Hz以下)	1個1校正周波数につき	133,700	1校正周波数を追加する毎に11,300円を加算する。
		音響校正器	発生音圧レベル: 94 dB 以上 124 dB 以下 周波数範囲: 31.5 Hz 以上 16 kHz 以下	1台, 1音圧レベル, 1周波数につき	36,600	1音圧レベル, または1周波数点を追加する毎に3,500円追加する。
		音響パワーレベル(基準音源)	100 Hz 以上10 kHz 以下 (1/3 octave band)	1個につき	273,500	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
15	超音波	音場感度(ハイドロホン)	100 kHz以上1 MHz以下(周波数間隔50 kHz、19点校正)	1個19周波数につき	232,700	
			0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数につき	139,300	1周波数を追加する毎に600円を加算する。 (参考例) 1 MHz毎に1 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は150,700円(20校正点) 0.1 MHz毎に0.5 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は 256,300円(196校正点)
			21 MHz 以上40 MHz 以下(周波数間隔1 MHz、20周波数以内)	1個20周波数以内につき	153,500	メムレン型ハイドロホン(受波部直径公称値0.5 mm 以下)
		超音波音場パラメタ	0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数1測定面につき	50,300	
		超音波パワー	1 mW以上15 W以下(0.5 MHz以上15 MHz以下) 1 mW以上500 mW以下(15 MHz以上20 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	75,500	1周波数又は1パワーを追加する毎に46,200円を加算する。
			15 W以上100 W以下(1 MHz以上3 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	83,000	1周波数又は1パワーを追加する毎に19,300円を加算する。
16	振動加速度	位相シフト	振動数:20 Hz から5 kHzの1/3オクターブ毎の25点	1個につき	143,000	振動ピックアップの取付に関わる治具等の費用は含まない。
			振動数:1 Hzから40 Hzの1/3オクターブ毎の16点	1個につき	121,500	振動ピックアップの取付に関わる治具等の費用は含まない。
17	衝撃加速度	電圧感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> 、5 000 m/s <sup>2</sup> )につき	124,400	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に37,300円を加算する。
		電荷感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> 、5 000 m/s <sup>2</sup> )につき	178,300	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に45,600円を加算する。
18	角振動・角速度	ジャイロスコープ	-5.2 rad/s ~ +5.2 rad/s (-0.087 rad/s を超え0.087 rad/s 未満の範囲を除く。) [-300° /s ~ +300° /s (-5° /s を超え5° /s 未満の範囲を除く。)]	1個10校正点まで	153,000	アナログ出力に限る。 1校正点を追加する毎に、11,500 円を加算する。
19	直流・低周波	変流器	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数:45, 50, 55, 60, 120, 200, 400, 700, 1 000 Hz 試験変流比:1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上100 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。

			試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数:2 000, 4 000 Hz 試験変流比:1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流に つき (試験変流比 の各レンジに おける10試験 点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。
		蓄電キャパシタの内部インピーダンス	キャパシタンス(10 mF)	1個につき	112,200	校正依頼品は、内部起電力をもたない標準用のキャパシタであること。
		蓄電池の内部インピーダンス測定器	1 Ω ~ 100 Ω / 1 kHz	1個19点につき	465,600	校正依頼品は、蓄電池の内部インピーダンス測定器であって、4端子対定義に基づく測定方式であること。計測器における直流電圧の設定は、0 Vに限定する。 基本校正点は、1 Ω ~ 10 Ω (1 Ωきざみ)、及び、10 Ω ~ 100 Ω (10 Ωきざみ)の計19点とする。 基本校正点以外のインピーダンス値を追加する毎に、25,000円を加算する。
20	高周波	利得(ホーンアンテナ)	周波数:W バンド (75.0 GHz 以上 110.0 GHz 以下) 0.5 GHz 間隔の71 校正点	1個1バンドにつき	348,100	W バンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格:WR10、フランジ規格:UG-385 互換)を有する直線偏波ホーンアンテナ。ただし、公称利得が15 dBi 以上 30 dBi 以下の範囲にあること。 校正する方向はアンテナの導波管端面に対する垂直方向。
		応答非直線性(光パワーメータ)の波長依存性試験	770 nm 帯、850 nm 帯、1 010 nm 帯: 1 nW レベルを基準とした応答非直線性(2 nW レベル以上1 mW レベル以下)	1台1波長帯域 20 試験点まで	74,100	波長755 nm 以上 785 nm 以下、820 nm 以上 860 nm 以下、または、970 nm 以上1 050 nm 以下の何れかの波長帯域において、任意の等間隔波長5点で測定した応答非直線性の基準値からの最大偏差の大きさ。 空間ビーム系。 同一波長帯の応答非直線性(光パワーメータ、空間ビーム系)の校正值(基準値)を有すること。
			850 nm 帯、-10 dBm (100 μW)を基準とした光パワーメータの指示値[-3 dB, -50 dB]区間における応答非直線性(dB 値)	1台24試験点 まで	104,100	波長840 nm 以上 860 nm 以下の範囲において5 nm 間隔で応答非直線性を測定した時の、波長850 nm での基準値、及び基準値に対する最大偏差の大きさ。 光ファイバ系。 同一波長帯の応答非直線性(光パワーメータ、光ファイバ系)の校正值(基準値)を有すること。
		光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	107,800	1パワーレベルを追加する毎に46,500 円を加算する。 波長は 840 nm 以上 860 nm以下の範囲で任意に選択可能。
			1310 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	125,100	1波長点1パワーレベルを追加する毎に18,000円を加算する。 波長は 1260 nm 以上 1360 nm 以下の範囲で任意に選択可能。
			1550 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	124,600	1波長点1パワーレベルを追加する毎に17,900円加算する。 波長は 1520 nm 以上 1630 nm 以下の範囲で任意に選択可能。

	光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)の波長依存性試験	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	101,500	試験波長は840 nm 以上 860 nm 以下の任意の連続波長範囲内で等波長間隔ごとに5点。同一波長帯の光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)の校正値(基準値)を有すること。	
		1 310 nm帯、光ファイバパワー50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	107,100	1試験波長範囲1パワーレベルを追加する毎に36,100円を加算する。試験波長は1260 nm 以上 1360 nm以下の任意の連続波長範囲内で等波長間隔ごとに11点。同一波長帯の光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)の校正値(基準値)を有すること。	
		1 550 nm帯、光ファイバパワー50 $\mu$ W ~ 1mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	106,600	1試験波長範囲1パワーレベルを追加する毎に35,900円を加算する。試験波長は1520 nm 以上 1630 nm以下の任意の連続波長範囲内で等波長間隔ごとに11点。ただし、1520 nm - 1630 nmの範囲で、10 nm間隔毎の場合は12点。同一波長帯の光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)の校正値(基準値)を有すること。	
		レーザーパワー	レーザー波長0.8 $\mu$ m レーザーパワー1 W以上10 W以下	1個1パワーにつき	172,900	1パワーを追加する毎に40,900円を加算する。
			レーザー波長 1.1 $\mu$ m レーザーパワー 1 kW	1個1パワーにつき	1,128,000	
		レーザーパワー(ビームプロファイラ)	レーザー波長1.06 $\mu$ m レーザーパワー1 mW以上1 W以下	1個1パワーにつき	205,700	校正器物は、CCDを用いたレーザービームプロファイラ。 1パワーを追加する毎に87,300円を加算する。
	電磁界強度	電界プローブ 周波数 2.45 GHz 電界強度 10 V/m	1個1電界ベクトル方向につき	190,700	電界ベクトル方向を1 方向追加する毎に42,900円を加算する。	
21	測光量・放射量	分光応答度	紫外域 波長200 nm以上300 nm以下5 nm毎	1個につき	181,500	
			赤外域 波長800 nm以上 1 650 nm以下5 nm毎	1個につき	223,900	
		分光放射照度応答度	波長 360 nm 以上830 nm 以下5 nm毎	1個につき	185,400	オーバーフィル条件(A m <sup>2</sup> /W)による測定
		分光拡散反射率	(赤外域) 拡散反射板 波長:810 nm以上2 500 nm以下、10 nm間隔 反射率:80 %以上	1枚につき	268,200	2枚目以降の校正は、1枚につき109,900円を加算する。(最大3枚まで)
		近・遠紫外域放射束	校正対象:重水素ランプ。校正波長180 nm-320 nm、10 nm ステップ 校正波長±10.0 nm の波長幅内での放射束	1個につき	549,700	校正対象の代表的仕様(その他の仕様は直接ご確認ください)。 AC100 V 動作可の専用点灯電源を持ち、180 nm - 320 nm の波長域の放射を持つ重水素ランプである事。バルブ底面に固定用の円盤型フランジを持つ構造である事。円盤型フランジには固定用の穴が2か所以上あり、3 mm 径以上の大きさである事。バルブ径は30 mm程度である事。固定用フランジから40 mm 以上45 mm 以下の高さに発光部がある構造である事。

		N-9 分光全放射束 (4 $\pi$ 放射光源用)	校正対象:ハロゲン電球(JD型、定格24 V,150 W) 波長:360 nm以上830 nm以下、5 nm間隔	電球1個につき	421,300	全光束の校正を含む。2~3個目は電球1個につき、114,700円を加算する。 ハロゲン電球は、十分な枯化、安定性確認、および再現性確認の実績を有するもので、規定の口金アダプタを装着のこと。
22	放射線	照射線量(率)測定器	マンモグラフィX線(Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al)	1台1校正点につき	144,900	1点を追加する毎に39,600円を加算する。
		放射線量検出素子	マンモグラフィX線(Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al)	1回照射につき	124,800	1照射を追加する毎に23,400円を加算する。
		X線照射試験	マンモグラフィX線(Mo/Mo,Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al)	1日につき	124,800	国家標準にトレーサブルな参照標準器を保有していること。詳細はお問い合わせ願います。
		放射線治療用水吸収線量測定器 (3校正点)	高エネルギー光子線(6, 10, 15 MV)	1台3校正点又は3試験点につき	244,500	基本料金の校正点は公称加速電圧が6MV、10MV、15MVの3点とする。1校正点又は1試験点を追加する毎に43,800円加算する。
		放射線治療用水吸収線量検出素子 (4校正点)	Co- $\gamma$ 線, 高エネルギー光子線(6, 10, 15 MV)	1個4校正点につき	57,400	放射線治療用線量計の分離校正(対象計量器は要問合せ) 基本料金の校正点はCo- $\gamma$ 線, 高エネルギー光子線 6 MV, 10 MV, 15 MVの4校正点とする。 1校正点を追加する毎に13,900円加算する。
		放射光軟X線フルエンス (現地校正)	単色軟X線エネルギーの範囲:90 eV 以上 3900 eV 以下	1個1点につき	153,500	1点を追加する毎に 4,100円を加算する。 現地校正のみ。
		$\beta$ 線	$\beta$ 線組織吸収線量率測定器 $\beta$ 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	104,300	1点を追加する毎に16,600円を加算する。
			$\beta$ 線組織吸収線量測定器 $\beta$ 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	112,700	1点を追加する毎に 24,900円を加算する。
			$\beta$ 線組織吸収線量検出素子 $\beta$ 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	94,000	1点を追加する毎に18,700円を加算する。
			$\beta$ 線水吸収線量率測定器 $\beta$ 線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	120,000	1点を追加する毎に14,500円を加算する。
			$\beta$ 線水吸収線量測定器 $\beta$ 線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	127,300	1点を追加する毎に21,900円を加算する。
		基準空気カーマ率(ヨウ素125 密封小線源)	ヨウ素125 密封小線源	1個につき	114,000	1個追加する毎に 70,000円を加算する。 WS 使用の場合
			密封小線源測定器	1個につき	126,400	1個追加する毎に 82,400円を加算する。
		基準空気カーマ率イリジウム192 密封小線源)	密封小線源測定器	1台1校正点につき	199,900	
23	放射能	放射能濃度	4 $\pi$ $\beta$ - $\gamma$ 測定装置による絶対測定校正試験 100 kBq/g 以上 2 MBq/g以下のもの	1個につき	68,800	
		電離箱又はGe半導体検出器による比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個につき	24,800		
		TDCR装置による絶対測定校正試験(H-3,C-14) 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個につき	231,600		
		液体シンチレーションカウンタによる比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの (核種は問い合わせのこと)	1個につき	135,600	H-3標準溶液の供給がない場合、H-3での絶対測定校正試験と同時に行うことが必要	
		放射能濃度(放射性ガス)	1 Bq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以下のもの	1個につき	1,016,400	放射能(濃度)を1点追加するごとに173,500円を加算する。

		放射能試料	粒子放出率・スペクトル試験2 kBq以上4 MBq以下のもの	1試料につき	48,600	
			$\gamma$ (X)線放出率の遠隔校正 範囲:2 ks <sup>-1</sup> 以上4 Ms <sup>-1</sup> 以下および50 keV以上1.8 MeV以下のもの	1個1核種につき	42,200	1核種を追加する毎に3,100円を加算する。
				初回設定手数料	12,400	
		放射能(放射性ガス)	5 kBq 以上3 MBq 以下のもの	1個につき	1,016,400	放射能(濃度)を1点追加するごとに173,500円を加算する。
		放射能測定器	校正試験20 Bq/g以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	66,500	1核種を追加する毎に66,500円を加算する。
			$\gamma$ 線核種用放射能測定用電離箱の遠隔校正 範囲:40 kBq/g以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	41,800	1核種を追加する毎に3,100円を加算する。
				初回設定手数料	12,200	
		放射性ガスモニタ	30 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上100 Bq・cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスがPR ガス又はメタンガスであるもの	1個につき	1,041,000	放射能濃度を1点追加するごとに186,200円を加算する。
			30 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq・cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスが乾燥空気であるもの	1個につき	1,496,700	放射能濃度を1点追加するごとに151,000円を加算する。
		放射能面密度	Am-241コイン状線源0.3 Bq/cm <sup>2</sup> 以上1 MBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき	111,500	
Cl-36大面積線源2 Bq/cm <sup>2</sup> 以上 1 kBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき		133,600			
環境レベル放射能	体積線源の $\gamma$ 線スペクトロメトリ20 Bq/g 以上100 kBq/g以下のもの	1個につき	91,300			
$\gamma$ 線核種放射能	密封線源又はアンブル線源 $\gamma$ 線エネルギーが20 keV以上3 MeV以下で、2 kBq 以上4 MBq以下のもの	1個につき	62,900			
24	中性子	中性子測定器校正試験	速中性子フルエンス エネルギー点:144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス範囲:1.0×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0×10 <sup>12</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
			速中性子フルエンス率 エネルギー点:144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス率範囲: 144 keV: 2.3×10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上1.8×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 565 keV: 6.3×10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上5.1×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 5.0 MeV: 2.5×10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上2.0×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 14.8 MeV: 3.8×10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上6.1×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点:2.5 MeV フルエンス範囲:1.0×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0×10 <sup>11</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	247,800	4試験点以上6試験点以下は124,800円、7試験点以上9試験点以下は247,800円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点:8.0 MeV(3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲:1.0×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0×10 <sup>12</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個1試験点につき	103,700	1試験点を追加する毎に48,600円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点:8.0 MeV(3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲:1.0×10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0×10 <sup>12</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個1試験点につき	171,500	1試験点を追加する毎に89,600円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス範囲: 1.0x10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0x10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき	230,500	1試験点を追加する毎に76,300円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。

	速中性子フルエンス率 エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス率範囲: $1.6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 以上 $1.4 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 以下	1個1試験点につき	230,500	1試験点を追加する毎に76,300円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
	熱中性子フルエンス フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 \text{ m}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^{12} \text{ m}^{-2}/\text{s}$ 以下	1個3試験点以下につき	285,800	4試験点以上6試験点以下は143,900円、7試験点以上9試験点以下は287,900円を加算する。
	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲: $5.0 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}$ 以下	1個3試験点以下につき	285,800	4試験点以上6試験点以下は143,900円、7試験点以上9試験点以下は287,900円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点: 24 keV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1個1試験点につき	144,800	1試験点を追加する毎に75,600円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点: 24 keV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^3 /\text{m}^2/\text{s}$ 以上 $1.6 \times 10^6 /\text{m}^2/\text{s}$ 以下	1個1試験点につき	144,800	1試験点を追加する毎に75,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類: $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 線源種類: $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be フルエンス率範囲: Am-Be: $4.1 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $1.7 \times 10^2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下 $^{252}\text{Cf}$ : $2.0 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $4.9 \times 10^2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) フルエンス率範囲: $8.8 \times 10^2 /\text{cm}^2$ 以上 $8.9 \times 10^7 /\text{cm}^2$ 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) フルエンス率範囲: $1.7 \times 10^1 /\text{cm}^2/\text{s}$ 以上 $4.4 \times 10^2 /\text{cm}^2/\text{s}$ 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率(現地校正) エネルギー点: 45 MeV フルエンス率範囲: $5.0 /\text{cm}^2/\text{s}$ ~ $2.5 \times 10^4 /\text{cm}^2/\text{s}$	1個1試験点につき	395,700	校正器物1個または1試験点追加する毎に26,800円を加算する。
中性子測定器照射試験	速中性子フルエンス エネルギー点: 144 keV, 565 keV, 5.0 MeV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1照射につき	103,700	同じエネルギー点1照射を追加する毎に48,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 2.5 MeV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{11} /\text{m}^2$ 以下 エネルギー点: 14.8 MeV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1照射につき	111,600	同じエネルギー点1照射を追加する毎に51,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 8.0 MeV (3.5 MeV補正照射なし) フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1照射につき	103,700	同じエネルギー点1照射を追加する毎に48,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 /\text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} /\text{m}^2$ 以下	1照射につき	171,500	1照射を追加する毎に89,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1個1試験点につき	230,500	1照射を追加する毎に76,300円を加算する(最大5照射まで)。6照射目以降は基本手数料を適用する。

	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲: $5.0 \times 10^5$ /m <sup>2</sup> /s 以上 $1.0 \times 10^8$ /m <sup>2</sup> /s 以下	1照射につき	88,300	1照射を追加する毎に82,100円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点: 24 keV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7$ /m <sup>2</sup> 以上 $1.0 \times 10^{12}$ /m <sup>2</sup> 以下	1照射につき	144,800	1照射を追加する毎に75,600円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点: 24 keV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^3$ /m <sup>2</sup> /s以上 $1.6 \times 10^6$ /m <sup>2</sup> /s以下	1照射につき	144,800	1照射を追加する毎に75,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7$ /m <sup>2</sup> 以上 $1.0 \times 10^{12}$ /m <sup>2</sup> 以下	1照射につき	131,300	1照射を追加する毎に97,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 <sup>252</sup> Cf) フルエンス範囲: $8.8 \times 10^2$ /cm <sup>2</sup> 以上 $8.9 \times 10^7$ /cm <sup>2</sup> 以下	1照射につき	137,700	1試験点を追加する毎に120,100円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率(現地校正) エネルギー点: 45 MeV フルエンス率範囲: $5.0$ /cm <sup>2</sup> /s ~ $2.5 \times 10^4$ /cm <sup>2</sup> /s	照射1時間につき	376,000	照射時間1時間追加する毎に、7,200円を加算する。
中性子個人線量計校正試験	中性子個人線量当量 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量範囲: $4.0 \times 10^{-4}$ mSv以上 $4.0 \times 10^1$ mSv以下 ( <sup>252</sup> Cf) $4.1 \times 10^{-4}$ mSv以上 $4.1 \times 10^1$ mSv以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子個人線量当量率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量率範囲: $2.9 \times 10^{-8}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以上 $7.1 \times 10^{-4}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以下 ( <sup>252</sup> Cf) $6.0 \times 10^{-7}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以上 $2.5 \times 10^{-4}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子個人線量当量 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量範囲: $9.7 \times 10^{-5}$ mSv以上9.8 mSv以下	1個1試験点につき	137,900	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	中性子個人線量当量率 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量率範囲: $7.0 \times 10^{-6}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以上 $1.8 \times 10^{-4}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
中性子サーベイメータ校正試験	中性子周辺線量当量 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量範囲: $3.9 \times 10^{-4}$ mSv以上 $3.9 \times 10^1$ mSv以下	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子周辺線量当量率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量率範囲: $2.8 \times 10^{-8}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以上 $6.8 \times 10^{-4}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以下 ( <sup>252</sup> Cf) $5.7 \times 10^{-7}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以上 $2.4 \times 10^{-4}$ Sv・h <sup>-1</sup> 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子周辺線量当量 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量範囲: $9.2 \times 10^{-5}$ mSv以上9.3 mSv以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	中性子周辺線量当量率 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量率範囲: $6.6 \times 10^{-6}$ Sv/h以上 $1.7 \times 10^{-4}$ Sv/h以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
中性子源校正試験	中性子放出率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 中性子放出率範囲: $1.0 \times 10^3$ /s以上 $3.0 \times 10^7$ /s以下 ( <sup>252</sup> Cf) $1.0 \times 10^3$ /s以上 $2.0 \times 10^7$ /s以下 (Am-Be)	1個につき	104,200	

25	温度	ガラス製温度計	精密温度計(校正温度範囲:0℃以上100℃以下、1目量 0.02℃以下)	1個0℃のほか5点まで	67,000	
		非接触温度計・校正装置	赤外放射温度計(160℃以上500℃以下のもの)	1個1点につき	143,400	1測定点を追加する毎に69,800円を加算する。
		極低温抵抗温度計	50 mK 以上 650 mK 以下(250 mKを超え400 mK 未満を除く)決められた24温度のみで校正をおこなう。	1本につき	1,251,800	校正器物を同時に5本まで校正する場合、1本追加につき26,200円を加算する。 【同時に6本以上8本以下で校正する場合】237,000円を加算する他、6本を超える本数1本につき26,800円を加算する。 【同時に9本以上12本以下で校正する場合】362,600円を加算する他、9本を超える本数1本につき26,200円を加算する。
26	湿度	露点計	露点範囲:+85℃以上 +95℃以下	1個1点につき	171,900	1測定点を追加する毎に50,600円を加算する。(追加は最大2測点まで)
			露点範囲:-70℃以上-10℃以下	1個1点につき	270,100	測定点1点を追加する毎に54,000円を加算する。(追加は最大6測点まで)
		物質分率表示が可能な微量水分計	ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点までにつき	864,600	各校正点の値の±10%以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個1点につき	510,200	校正点の値の±5%以内、又は±1 nmol/mol以内の差は許容とする。 1校正点を追加する毎に261,000円を加算する。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol, 3 000 nmol/mol, 5 000 nmol/mol の8 校正点	1個8校正点までにつき	986,400	各校正点の値の±10%以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:アルゴン 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点までにつき	908,800	各校正点の値の±10%以内、又は±2 nmol/mol 以内の差は許容とする。
			ガス種:ヘリウム 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点までにつき	1,044,200	各校正点の値の±10%以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:酸素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点までにつき	1,154,600	各校正点の値の±10%以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
物質分率表示が可能な微量水分計の応答試験	12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個、測定14日間につき	675,000	1日追加する毎に59,000円を加算する。		
27	熱物性	熱膨張率(線膨張係数)	試験対象物質:ガラス状炭素または単結晶シリコン 測定温度範囲:293 K以上1 000 K以下	1個につき	259,800	
			試験対象物質:JIS B7506 で定めるブロックゲージと同等な形状精度をもつ固体試験片 呼び寸法の範囲:20 mm以上100 mm以下 測定温度範囲:5℃以上35℃以下	1校正点につき	45,600	1校正点を追加する毎に20,500円を加算する。
		熱拡散率	4枚組(室温)	1件につき	133,800	
			4枚組(500 K+700 K+ 900 K+1 200 K)	1件につき	374,400	



			1枚組(室温)	1件につき	43,700	
			1枚組(高温 500 K以上1 200 K以下1点)	1件1点につき	60,700	1測定点を追加する毎に33,700円を加算する。
			1枚組(高温1 200 Kを超え1 500 K以下1点)	1件1点につき	68,200	1測定点を追加する毎に33,700円を加算する。
		比熱容量測定	1枚(300 K以上900 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	73,100	1点を追加する毎に39,400円を加算する。
			1枚(900 K以上1 600 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	74,300	1点を追加する毎に39,900円を加算する。
			1枚(50 K以上350 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	152,900	1点を追加する毎に 56,000円を加算する。
		熱流密度	校正対象:熱流センサ (1辺9 mm 以上50 mm 以下の平板状)	1個2点につき	156,600	2点を超え1点増す毎に、56,100円を加算する。
28	硬さ	微小硬さ	熔融石英・BK7ガラス 試験力 100 mN	1個につき	114,800	測定温度は26 °C。
		ロックウェル硬さ標準片	Bスケール 30 HRBW 以上100 HRBW 以下	3個まで	120,200	
29	衝撃値	衝撃試験機		1台につき	283,300	検査対象試験機は、JIS B7740の基準機試験機に相当する試験機であること。
30	粒子・粉体特性	粒径	粒径20 nm以上300 nm以下	1試料につき	418,800	
			粒径100 nm以上1 μm以下	1試料につき	524,200	
			粒径分布幅 粒径20 nm以上300 nm以下の粒径標準ポリスチレンラテックス粒子	1試料につき	418,800	粒径分布幅は粒径の0.3倍以下
			粒径および粒径分布幅 粒径20 nm以上300 nm以下の粒径標準 ポリスチレンラテックス粒子	1試料につき	518,400	粒径分布幅は粒径の0.3倍以下
		粒子質量	粒子質量500 ag以上500 fg以下	1試料につき	459,900	
		粒子数濃度	気中 濃度 $1 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 以上 $4 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 以下(粒径 10 nm以上300 nm以下) 濃度 $4 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 以上 $1 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 以下(粒径 10 nm以上200 nm以下) 濃度 $1 \times 10^0 \text{ cm}^{-3}$ 以上 $1 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$ 以下(粒径 30 nm以上60 nm以下)	1試料(5校正点を含む。)につき	494,000	1校正点を追加する毎に81,300円を加算する。
			液中 粒径 $2 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 以下 濃度 $5 \times 10^8$ 個/g以上 $2 \times 10^6$ 個/g以下	1試料につき	582,000	希釈有
			液中 粒径 $2 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 以下 濃度 $5 \times 10^2$ 個/g 以上 $5 \times 10^3$ 個/g 未満	1試料につき	576,700	希釈無
			液中 粒径 600 nm以上 $2 \mu\text{m}$ 未満 濃度 $5 \times 10^2$ 個/g 以上 $1 \times 10^3$ 個/g 未満	1試料につき	625,100	希釈無
			液中 粒径 600 nm 以上 $2 \mu\text{m}$ 未満 濃度 $1 \times 10^3$ 個/g 以上 $2 \times 10^6$ 個/g 以下	1試料につき	630,400	希釈有

		気中粒子数	光散乱式気中粒子計数器の検出効率(粒子数基準および粒子数濃度基準) 粒子計数頻度: $10\text{ s}^{-1} \sim 100\text{ s}^{-1}$ 粒径範囲: $0.5\ \mu\text{m} \sim 10\ \mu\text{m}$	1台につき(2粒径、1粒子計数頻度)	243,700	3粒径以上の場合には、1粒径につき25,800円を加算する。同一粒径において粒子計数頻度を追加する場合には、10,700円を加算する。粒径は以下の①または②のシリーズから選択し、このシリーズの中から粒径を選択する。① $10\ \mu\text{m}$ , $6\ \mu\text{m}$ , $3\ \mu\text{m}$ , $2\ \mu\text{m}$ , $1\ \mu\text{m}$ , $0.7\ \mu\text{m}$ , $0.5\ \mu\text{m}$ ② $5\ \mu\text{m}$ , $2\ \mu\text{m}$ , $1\ \mu\text{m}$ , $0.5\ \mu\text{m}$ 定格流量範囲: $0.3\text{ L/min} \sim 30\text{ L/min}$ (参考) 粒子数濃度流量 $30\text{ L/min}$ の場合、 $0.02\text{ cm}^{-3} \sim 0.2\text{ cm}^{-3}$ 流量 $0.3\text{ L/min}$ の場合、 $2\text{ cm}^{-3} \sim 20\text{ cm}^{-3}$
31	純度	高純度有機標準物質	核磁気共鳴法及び凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下)	1試料につき	157,600	
			核磁気共鳴法による純度測定(純度範囲 90%以上100%以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	105,400	
			核磁気共鳴法による純度測定(純度範囲 90%以上100%以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	99,800	
			凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	115,100	
			凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	111,300	
			核磁気共鳴法及び滴定法による純度測定(純度範囲 60%以上100%以下)	1試料につき	241,900	分析対象成分以外の有機化合物の総量が10%を超えないこと
32	薄膜・多層膜	膜厚	X線反射率法による薄膜・多層膜構造の膜厚校正(各層1nm以上200nm以下、総膜厚3nm以上200nm以下)	1個につき	258,600	1校正点を追加する毎に215,000円を加算する。
33	濃度	標準ガス	三ふっ化窒素の濃度測定( $4\ \mu\text{mol/mol}$ 以上 $10\ \mu\text{mol/mol}$ 以下)	1試料につき	290,100	
			ホルムアルデヒドの濃度測定( $1\ \mu\text{mol/mol}$ 以上 $8\ \mu\text{mol/mol}$ 以下)	1試料につき	335,200	
34	分子量	高分子標準物質	静的光散乱法による質量平均モル質量 プルラン[CAS No. 9057-02-7] $2 \times 10^5\text{ g mol}^{-1}$ 以上 $8 \times 10^5\text{ g mol}^{-1}$ 以下	1試料につき	283,400	乾燥粉末状態のもの
51	計量器の構成要素及び検査装置の試験	はかりの制温装置(試験温度 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ )		1個につき	53,400	
		はかり・制温ばね等の温度による試験		1件につき	82,700	
		質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	49,700	
		JIS B 7611-2(環境試験レベルH)			395,400	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に196,900円を加算する。
		JIS B 7611-2(環境試験レベルL)			220,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に109,100円を加算する。
		型式の追加及び変更(個別項目)			127,300	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に62,500円を加算する。 1試験項目を追加する毎に37,800円を加算する。

		型式の変更及び追加(試験なし)		49,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用指示計(アナログ信号)		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	49,700		
		JIS B 7611-2(環境試験レベルH)		877,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、263,200円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に438,200円を加算する。	
		JIS B 7611-2(環境試験レベルL)		678,500	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、203,500円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に338,600円を加算する。	
		型式の追加及び変更(個別項目)		218,000	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 試験器物を1台追加する毎に108,400円を加算する。 1試験項目を追加する毎に65,400円を加算する。	
		型式の変更及び追加(試験なし)		49,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用ロードセル (OIML R60に対応する型式)		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	49,700		
	アナログロードセル	最大容量 100 kg 以上1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	434,600	器物を1台追加する毎に247,900円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	448,800	器物を1台追加する毎に249,000円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	249,000	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	427,900	
	アナログロードセル	最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	575,400	器物を1台追加する毎に380,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	595,500	器物を1台追加する毎に 382,600円を加算する。(一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	382,600	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	566,600	
	デジタルロードセル	最大容量 100 kg 以上1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	877,200	器物を1台追加する毎に247,900円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	891,400	器物を1台追加する毎に249,000円を加算する。 (一部試験については除外)

				型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	249,000		
				型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	427,900		
				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	129,500		
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	365,500		
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下		精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1,018,100	器物を1台追加する毎に380,500円を加算する。 (一部試験については除外)	
				精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1,038,100	器物を1台追加する毎に383,100円を加算する。 (一部試験については除外)	
				型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	382,600		
				型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	566,600		
				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	202,000		
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	365,500		
				伸縮率、増加率、減少率(ガスメーター用膜)	1型式につき	88,400		
				燃料油メーター用空気分離器	1個につき	88,500		
			燃料油メーター用ホース	1個につき	10,400			
			燃料油メーター用表示装置	1件につき	363,000			
		特定計量器外部接続装置の性能試験	タクシーメーター	1件につき	244,900			
			燃料油メーター用販売時点情報管理装置	1件につき	363,000			
		計量性能確認試験	最大容量100 kg以上1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD	1台につき	249,000		
			最大容量2 500 kg以上20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD	1台につき	382,600		
		試験装置の認定試験	初回試験		1件につき	34,200		
			次回以降試験		1件につき	9,300		
52	その他	体積	200 L以下			46,400	予備ゲージを使用するものについては、1本を追加する毎に23,200円を加算する。 試験液が油の場合は、23,200円を加算する。	
			200 Lを超えるもの			137,000		予備ゲージを使用するものについては、1本を追加する毎に68,500円を加算する。 試験液が油の場合は、68,500円を加算する。
		流量	石油用	口径80 mm以下		1個1流量につき	12,700	
				口径80 mmを超えるもの		1個1流量につき	18,000	
53	OIML適合性試験	既存のOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書、OIML-CS適合証明書又はNMIJが発行した試験報告書のみで審査する場合(新たな試験の実施を完全に省略する場合)の審査料 1件につき 49,700円 下記の手数料(基本料金)には審査料が含まれています。						

非自動はかり	1992年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	853,600	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、669,900円(税別)を限度として、これを基本料金から減算する。		
	2006年版の技術基準に基づく証明書 完成はかり 試験対象:ひょう量 300 kgまで		1件につき	1,058,000	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、680,500円(税別)を限度として、これを基本料金から減算する。		
質量計用ロードセル	2000年版の技術基準に基づく証明書 アナログロードセル	タイプ:ビーム式 出力信号:アナログ信号 ひょう量:200 kg及び1 000 kg 湿度記号:NH 精度等級:C3(目量の数 3 000以下)及びD		1件につき	435,900		
		最大容量 100 kg 以上 1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	478,200	器物を1台追加する毎に291,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	492,400	器物を1台追加する毎に292,600円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)		1台につき	292,600	
	型式の追加試験(計量性能+湿度試験)		1台につき	471,500			
	最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	619,000	器物を1台追加する毎に424,000円を加算する。 (一部試験については除外)	
		精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	639,000	器物を1台追加する毎に426,200円を加算する。 (一部試験については除外)	
		型式の追加試験(計量性能試験)		1台につき	426,200		
		型式の追加試験(計量性能+湿度試験)		1台につき	610,100		
	2000年版の技術基準に基づく証明書 デジタルロードセル	最大容量 100 kg 以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	920,800	器物を1台追加する毎に291,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	935,000	器物を1台追加する毎に292,600円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)		1台につき	292,600	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)		1台につき	173,100	
			型式の追加試験(影響試験)		1台につき	471,500	
			型式の追加試験(妨害試験)		1台につき	409,000	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	1,061,600	器物を1台追加する毎に424,000円を加算する。 (一部試験については除外)
精度等級C6以下及びD、湿度記号SH			1件につき	1,081,600	器物を1台追加する毎に426,200円を加算する。 (一部試験については除外)		
型式の追加試験(計量性能試験)			1台につき	426,200			
型式の追加試験(計量性能+湿度試験)			1台につき	610,100			

				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	245,600	
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	409,000	
発行済みのOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書又はOIML-CS適合証明書の申請者名、申請者住所等の変更に伴う審査料 1件につき 0円							

別表2-2 計量の標準に係る校正、試験等

(校正機関の認定制度の運用に必要な技能試験等の実施のために使用する計量器又は国若しくは国に準ずる機関が使用する計量器であって、研究所が必要と判断するもの)

●依頼試験手数料の額(消費税等抜き)は、別表2-2内手数料の額に校正証明書手数料の額を加えた額になります。

校正証明書手数料

和文 1部につき 1,300円 (正本・複本とも同じ)  
 英文 1部につき 2,300円 (正本・複本とも同じ)

No.	種類	項目	細目	手数料(基本料金)(円)		備考
1	長さ	波長(周波数)安定化レーザ	波長500 nm以上1 684 nm以下(原子・分子吸収線に安定化したもの)	1個につき	349,000	
		波長計	校正波長1 530 nm以上1 565 nm 以下 (通信帯Cバンド内)	1個、校正波長 1点につき	349,000	校正波長1点を追加する毎に、66,300円ずつ加算する。
3	時間	位相雑音	位相雑音測定器 キャリア周波数:10 MHz、100 MHz 離調周波数:10 Hz~1 MHz 位相雑音レベル:-70 dBc/Hz~-100 dBc/Hz キャリアレベル:+10 dBm~-10 dBm	1台1キャリア周 波数、1位相雑 音レベル、1キ ャリアレベルに つき	93,700	1キャリア周波数、1位相雑音レベル又は1キャリアレベルを追加するごとに13,000円を加算する。
			位相雑音発生器 キャリア周波数:10 MHz 離調周波数:10 Hz~49 Hz、51 Hz~990 kHz キャリアレベル:+10 dBm~-10 dBm	1台1キャリアレ ベルにつき	108,400	1キャリアレベルを追加するごとに12,900円を加算する。位相雑音レベルは離調周波数10 Hz~49 Hz、51 Hz~290 Hzでは-70 dBc/Hz~-127 dBc/Hzの範囲であること。離調周波数300 Hz~2.9 kHzでは-70 dBc/Hz~-135 dBc/Hzの範囲であること。離調周波数3 kHz~990 kHzでは-70 dBc/Hz~-140 dBc/Hzの範囲であること。位相雑音測定器への入力は正弦波であること。
4	質量	高精度分銅	1 kg	1個につき	287,600	
5	力	高精度力計	最大荷重1 MN以下のもの	1個につき	110,500	
			最大荷重1 MNを超えるもの	1個につき	291,300	
9	真空	熱伝導真空計 隔膜真空計 粘性真空計	基準真空計との比較によるもの0.1 Pa以上130 Pa以下、窒素	1個11圧力点 につき	214,200	6圧力点を増す毎に 77,100円を加算する。
10	流量	気体小流量	比較法	1個、気体1種 類につき	451,700	
		微風速	超音波風速計(0.05 m/s以上1.5 m/s以下)	1個につき	172,800	
11	密度	密度標準液	有機液体	1試料1温度に つき	77,600	

			バイオ燃料	1試料1温度につき	47,000	1温度を追加する毎に8,400円を加算する。
		密度浮ひょう	衡量法 0.600 g/cm <sup>3</sup> 以上 2.000 g/cm <sup>3</sup> 以下のもの	1個につき	103,300	
		比重浮ひょう	衡量法 0.600 以上 2.000 以下のもの	1個につき	103,300	
		酒精度浮ひょう	衡量法 0体積百分率以上100体積百分率以下	1個につき	103,300	
		日本酒度浮ひょう	衡量法 -40日本酒度以上+30日本酒度以下	1個につき	103,300	
		重ホーメ度浮ひょう	衡量法 0重ホーメ度以上72重ホーメ度以下	1個につき	103,300	
		液体の屈折率	屈折率標準液 屈折率1.1以上	1個につき	225,100	同温度において1個追加する毎に83,600円を加算する。
12	粘度・動粘度	粘度標準液	動粘度 20 °C~40 °C	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	72,400	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に27,900円を加算する。
			粘度 20 °C~40 °C	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	113,100	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に45,600円を加算する。
13	体積	フラスコ(受用)	5 mL以上10 L以下	1個につき	46,300	
		メスシリンダー(受用)	5 mL以上2 L以下	1個につき	44,000	
14	音響	サウンドレベルメータ	自由音場レスポンスレベル 周波数範囲:20 Hz 以上12.5 kHz以下,1/3オクターブバンド周波数	1個につき	144,100	
16	振動加速度	振動加速度計	校正範囲が0.1 Hz 以上2 Hz 以下のもの	1個につき	276,900	
			校正範囲が1 Hz 以上200 Hz 以下のもの	1個につき	307,200	
			校正範囲が20 Hz 以上5 kHz 以下のもの	1個につき	258,100	
			校正範囲が5 kHz 以上10 kHz 以下のもの	1個につき	201,100	
			ただし、校正範囲が0.1 Hz以上200 Hz以下のもの	1個につき	528,100	
			ただし、校正範囲が20 Hz以上10 kHz以下のもの	1個につき	445,700	
			標準ピックアップ	1個につき	77,200	
			電荷感度において、校正範囲が20 Hz以上5 kHz以下のもの	1個につき	306,300	
			電荷感度において、校正範囲が5 kHz以上10 kHz以下のもの	1個につき	212,600	
			ただし、電荷感度において、校正範囲が20 Hz以上10 kHz以下のもの	1個につき	506,500	
19	直流・低周波	誘導分圧器	0.1以上0.9以下@10 V, 100 V/1 kHz	1個1電圧につき	314,600	
			0.1以上0.9以下@10 V/100 kHz	1個につき	339,300	
			0.1以上0.9以下@10 V/200 Hz, 400 Hz, 10 kHz	1個1周波数につき	314,600	

	0.01以上0.09以下@10 V/200 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz	1個1周波数につき	314,600		
	0.05以上0.95以下@10 V/120 Hz	1個につき(0.1ステップ校正の場合)	394,700	0.05ステップ校正の場合276,300円を加算する。	
交直変換器	交流電圧用 試験電圧 0.01 V以上0.1 V以下、試験周波数 10 Hz以上 100 kHz以下のもの	1試験設定電圧につき (15試験点を含む)	211,900	1試験点を追加する毎に37,800円を加算する。 ただし、同一の標準器につき追加可能な試験点は50点までとする。	
	交流電圧用 試験電圧 0.3 V以上1 V以下、試験周波数 10 Hz以上 1 MHz以下のもの	1試験設定電圧につき (18試験点を含む)	147,500	1試験点を追加する毎に33,200円を加算する。 ただし、同一の標準器につき追加可能な試験点は50点までとする。	
	交流電圧用 試験電圧 2 V以上20 V以下、試験周波数 10 Hz以上 1 MHz以下のもの	1試験設定電圧につき	163,700	基本料金は同一の試験電圧において、同一の標準器で対応可能な周波数範囲毎に設定し、試験点は18点までとする。 同一の研究所の標準器で対応可能な周波数範囲において、1追加試験点を追加する毎に 3,400円を加算する。 ただし、同一の試験設定電圧につき追加可能な試験点は50点までとする。	
	交流電圧用 試験電圧 20 V以上1 000 V以下、試験周波数 10 Hz以上 100 kHz以下のもの	1設定電圧につき	209,500	基本料金は研究所の標準器1個で対応可能な一設定電圧毎に設定し、周波数試験点は18点までとする。 同一の研究所の標準器で対応可能な範囲において、1追加試験点を追加する毎に 4,300円を加算する。 ただし、同一の標準器につき追加可能な試験点は50点までとする。	
	遠隔校正 試験電圧 6V 試験周波数1 kHz	1個につき	98,600		
交直電圧比較装置	5 V, 6 V, 10 V, 40 Hz 以上60 Hz以下	1個5点まで (1電圧につき)	572,700	1点を追加する毎に41,100円を加算する。(同一電圧に限る)	
キャパシタ	範囲:0.01 $\mu$ F, 0.1 $\mu$ F, 1 $\mu$ F@1 kHz, @1.592 kHz, 10 $\mu$ F@1 kHz	1個につき	279,300		
	範囲:10 pF, 100 pF, 1 000 pF @1 kHz	1個につき	396,800		
	範囲:100 $\mu$ F @60 Hz, 120 Hz, 1 kHz	1個1周波数につき	443,000		
	範囲:1 000 $\mu$ F @60 Hz, 120 Hz, 1 kHz	1個1周波数につき	444,000		
変流器	試験変流器の同相差、直角相誤差が(0.02 %, 0.02 %)より小さいもの 試験周波数:45, 50, 55, 60, 65, 70, 120, 200, 400 Hz 試験1次電流50 A以下	試験変流比: 1以上100以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	93,500	10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に15,500円を加算する。 1試験1次電流を追加する毎に15,500円を加算する。 1試験負担を追加する毎に15,500円を加算する。 1周波数を追加する場合は、以上の合計した金額の1割を加算する。
		試験変流比:100以上10 000以下 試験1次電流5 A	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	147,800	10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に15,500円を加算する。 1試験負担を追加する毎に15,500円を加算する。 1周波数を追加する場合は、以上の合計した金額の1割を加算する。



	試験変流器の同相差、直角相誤差が(0.02%, 0.02%)より小さいもの 試験周波数: 700 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz 及び4 000 Hz 試験変流比: 1以上100以下 試験1次電流5 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	93,500	10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に15,500円を加算する。 1試験1次電流を追加する毎に15,500円を加算する。 1試験負担を追加する毎に15,500円を加算する。 1周波数を追加する場合は、以上の合計した金額の1割を加算する。
	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数: 45, 50, 55, 60, 120, 200, 400, 700, 1 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上100 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。
	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数: 2 000, 4 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に105,900円を加算する。
標準抵抗器	低抵抗 100 mΩ 及び10 mΩ	1個につき	256,900	
	低抵抗 1 mΩ	1個につき	370,800	
	1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ	1個1校正点につき	563,800	1 Ω 標準抵抗器群を基準にした校正。 エアバスもしくは油槽内もしくは校正机上に設置して測定する。精密測定の可能な標準抵抗器であること。
	1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ, 100 GΩ, 1 TΩ	1個1校正点につき	253,100	1 Ω 標準抵抗器群を基準にした校正。 エアバス内に設置して測定する。精密測定の可能な標準抵抗器であること。
	1 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 10 kΩ	1個1校正点につき	979,200	量子ホール効果抵抗測定装置による校正。 エアバスもしくは油槽内もしくは校正机上に設置して測定する。精密測定の可能な標準抵抗器であること。
インダクタ	10 mH@1 592 Hz	1個につき	341,500	
	10 mH, 100 mH@1 kHz	1個につき	341,500	
交直変換器	交流電圧用 校正電圧 1 V 周波数1 MHz 以上 50 MHz 以下のもの	1個3周波数点まで	660,600	2周波数点を追加する毎に21,200円を加算する。
交流電圧計	10 V, 40 Hz以上100 kHz以下	1周波数につき	498,100	1周波数を追加する毎に132,600円を加算する。
	10 V, 4 Hz以上10 Hz未満	1周波数につき	180,300	1周波数を追加する毎に51,900円を加算する。
	電圧実効値1 V, 4 Hz 以上10 Hz未満	1周波数につき	180,300	1周波数を追加する毎に51,900円を加算する。
高調波電圧電流発生器	100 V, 5 A, 62.5 Hz 50次高調波以下	1個1次～50次高調波まで	539,000	
パワーアナライザ	100 V, 5 A, 62.5 Hz 50次高調波以下	1個1次～50次高調波まで	566,600	

		交流抵抗器	10 kΩ @10 kHz	1個につき	342,500	
			1 kΩ、100 kΩ @1 kHz	1個につき	312,400	
			100 Ω、10 Ω @1 kHz	1個につき	316,500	
		蓄電キャパシタの内部インピーダンス	キャパシタンス(100 mF)	1個につき	112,200	校正依頼品は、内部起電力をもたない蓄電キャパシタであること。
		交流シャント	0.1 Ω / 5 A 又は 0.8 Ω / 1 A/45 Hz～65 Hz, 400Hz, 1 kHz, 3 kHz	1個1周波数につき	306,200	1周波数を追加する毎に214,800円を加算する。
20	高周波	アンテナ係数試験	ダイポールアンテナ 周波数:1 GHz以上2 GHz以下(100 MHz間隔で11周波数)	1式につき	472,900	ダイポールアンテナの自由空間アンテナ係数校正
			微小アンテナ(ループ) 周波数:20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz	1式につき	247,300	ただし、公称直径が133 mm、36回巻、アンテナエレメントの直径16 mm以下、アンテナの給電コネクタ端子が、PC-7のバッシブ型のループアンテナであること。
			ダブルリッチドアンテナ 周波数:1 GHz以上 6 GHz以下	1個11周波数につき	339,100	アンテナは測定装置に取付可能な構造・重量・形状であること。 11周波数点を超える場合は、40周波数点毎に、149,300円を加算する。
			エレメント長調整式のダイポールアンテナ	300 MHz,900 MHz の2周波数一式につき	449,300	
			微小アンテナ(ループ)周波数:9 kHz, 10 kHz, 150 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 5 MHz, 15 MHz, 30 MHz	1式につき	165,800	ただし、ループアンテナの直径が50 cmから60 cm、アンテナエレメントの直径が23 mm以下、アンテナの給電コネクタ端子はPC-7であること。
		同軸可変減衰器	プログラマブル可変減衰器:コネクタ N-50, 7 mm, 3.5 mm, 2.9 mm, 2.4 mm 周波数 100 kHz 以上 10 MHz 以下 減衰量 100 dB 以下	1周波数5校正点減衰量につき	99,600	同周波数5校正点を超える場合は1校正点毎に12,400円を加算する。
		導波管可変減衰器	周波数:18 GHz以上26.5 GHz以下 26.5 GHzを超え 40 GHz以下 減衰量:60 dB以下	1周波数3校正点減衰量につき	261,300	1周波数を追加する毎(3校正点減衰量含む。)に114,400円を加算する。 同周波数3校正点を超える場合は1校正点を追加する毎に 22,300円を加算する。
			周波数:50 GHz以上 75 GHz以下 減衰量:60 dB以下	1周波数3校正点減衰量につき	306,300	1周波数を追加する毎(3校正点減衰量含む。)に131,000円を加算する。 同周波数3校正点を超える場合は1校正点毎に25,200円を加算する。
			周波数:75 GHz 以上110 GHz 以下 減衰量:60 dB 以下	1個1周波数3減衰量につき	212,700	1 周波数(3減衰量含む)を追加する毎に96,100円を加算する。 同一周波数において3減衰量を超える場合は1 減衰量を追加する毎に19,200 円を加算する。
		高周波電力	導波管 ミリ波 50, 55, 60, 65, 70, 75 GHz, 1 mW, WR-15型	基本料金(校正点数を含まない。)	164,800	1校正周波数につき 13,100円を加算する。
			導波管 ミリ波 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 GHz, 0.1 mW, WR-10型	基本料金(校正点数を含まない。)	145,400	1校正周波数につき18,900円を加算する。
			導波管 ミリ波 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 GHz, 0.1 mWから1.2 mW, WR-06 型	1電力レベル(1校正周波数を含む。)	147,300	1校正周波数につき 22,700円を加算する。 校正器物は熱型センサに限る。
			7 mm同軸10 MHz以下 (100, 200, 500, 700, 1 000)kHz, 1 mW	1台につき	172,700	

	7 mm同軸 10 MHz 以上 18 GHz 以下:10 mW,1 mW	1台18周波数点につき	390,500	1周波数を追加する毎に 13,500円を加算する。 1周波数を削減する毎に 8,900円を減算する。
	2.9 mm同軸 10 MHz以上40 GHz以下: 1 mW, 10 mW	1台20周波数点につき	562,000	1周波数を追加する毎に 19,000円を加算する。 1周波数を削減する毎に 18,300円を減算する。
	2.4 mm同軸 1,2,5,6,10,15,18,20,25,26.5,30,33,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 GHz 1 mW	基本料金(校正点数を含まない。)	249,000	校正周波数1点につき 6,800円を加算する 50 GHz はV バンドカロリメータを基準とする比較校正。
高周波電圧	10 MHz 以上1 GHz 以下	1台5周波数点につき	214,600	1周波数を追加する毎に 11,100円を加算する。
利得(ホーンアンテナ)	周波数Kバンド(18 GHz~26.5 GHz) アンテナ利得15 dBi以上25 dBi以下	1個につき(周波数0.5 GHz 毎の周波数18点)	459,600	1周波数を追加する毎に22,400円を加算する。
	周波数:Gバンド(3.95 GHz, 4.9 GHz, 5.85 GHz), Cバンド(5.85 GHz, 7 GHz, 8.2 GHz) Xバンド(8.2 GHz, 10 GHz, 12.4 GHz), Pバンド(12.4 GHz, 15.2 GHz, 18 GHz), Kバンド(18 GHz, 22 GHz, 26.5 GHz)	1個1バンドにつき	384,900	ただし、各バンドのホーンアンテナは標準ホーンアンテナ開口部寸法が±1 mm以内で一致し、アンテナ給電部の導波管は置換法で使用するアンテナフランジと同一構造・寸法であること。
	周波数:Rバンド(1.7 GHz以上 2.6 GHz以下)任意周波数範囲を等間隔(0.1 GHz毎)に10周波数校正を行う。	1個10周波数につき	411,200	20周波数を増す毎に172,200円を加算する。
	周波数:Uバンド(26.5 GHz, 33 GHz, 40 GHz) 決められた3周波数でのみ校正を行う。	1個1バンドにつき	384,900	Uバンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格WR28。内寸 約7.2 mm×3.6 mm。フランジ寸法は規格に準拠したもの)に以下の開口と高さを持つ4角錐を接続した構造を持つホーンアンテナであること。開口寸法(E面 56 mm±2 mm、H面 69 mm±2 mm)、高さ 147 mm±5 mm、導波管長さ L= 3 cm程度
	周波数:Lバンド(1.00 GHz, 1.05 GHz, 1.15 GHz) 決められた3周波数でのみ校正を行う。	1個1バンドにつき	384,900	Lバンドのフランジ付き方形導波管(MIテクノロジー社製 MI-12-0.9と同等であること)に以下の開口と高さを持つ4角錐を接続した構造を持つホーンアンテナであること。開口寸法(E面 412 mm±4 mm、H面 556 mm±4 mm)、高さ 443 mm±5 mm、導波管長さ L= 15 cm程度
	周波数:Lバンド(1.15 GHz, 1.50 GHz, 1.70 GHz) 決められた3周波数でのみ校正を行う。	1個1バンドにつき	384,900	Lバンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格WR650。フランジ規格UG-418B/Uに準拠したもの)に以下の開口と高さを持つ4角錐を接続した構造を持つホーンアンテナであること。開口寸法(E面 412 mm±4 mm、H面 566 mm±4 mm)、高さ 411 mm±5 mm、導波管長さ L= 14 cm程度 上記Lバンドアンテナと導波管規格、アンテナ高が異なる。

	周波数:Sバンド(2.60 GHz, 3.27 GHz, 3.95 GHz) 決められた3周波数でのみ校正を行う。	1個1バンドにつき	384,900	Sバンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格WR284、フランジ規格UG-584/Uに準拠したもの)に以下の開口と高さを持つ4角錐を接続した構造を持つホーンアンテナであること。 開口寸法(E面 240 mm±1 mm、H面 324 mm±1 mm)、高さ 354 mm±5 mm、導波管長さ L= 7 cm程度
	周波数:Vバンド(50.0 GHz 以上 75.0GHz 以下) 0.5 GHz 間隔の51校正点	1個1バンドにつき	343,900	Vバンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格:WR15、フランジ規格:UG-385 互換)を有する直線偏波ホーンアンテナ。ただし、公称利得が15 dBi 以上 30 dBi 以下の範囲にあること。 校正する方向はアンテナの導波管端面に対する垂直方向。
	周波数:WR-03バンド(220 GHz以上330 GHz以下)310 GHz~317 GHzを除く1 GHz間隔の103 校正点	1個1バンドにつき	516,400	WR-03バンドのフランジ付き方形導波管(導波管規格:WR-03、フランジ規格:UG-387P互換)を有する直線偏波ホーンアンテナ。ただし、公称利得が15 dBi~30 dBiの範囲にあること。校正する方向はアンテナの導波管端面に対する垂直方向。
レーダ散乱断面積(三面コーナリフレクタ)	周波数:Wバンド(75.0 GHz以上110.0 GHz以下)0.5 GHz 間隔の71 校正点	1個につき	274,500	最大辺の寸法が75 mm以上、125 mm 以下であること。校正方向と反対方向に取り付け用のネジ穴を有すること。入射角と反射角が同一となるモノスタティックRCS 値を校正する。入射波および反射波の偏波は垂直偏波のみ。
レーダ散乱断面積(金属円柱)	周波数:Wバンド(75.0 GHz以上110.0 GHz以下)0.5 GHz 間隔の71 校正点	1個につき	274,500	高さ80 mm、半径80 mm程度の金属円柱。校正方向と反対方向に取り付け用のネジ穴を有すること。入射角と反射角が同一となるモノスタティックRCS 値を校正する。入射波および反射波の偏波は、円柱の軸方向と同一方向の偏波のみ。
レーダ散乱断面積(金属平板)	周波数:W バンド(75.0 GHz 以上 110.0 GHz 以下)0.5 GHz 間隔の71 校正点	1個につき	274,500	高さ:40 mm以上70 mm以下および幅:40 mm以上70 mm以下の金属平板。 校正方向と反対方向に取り付け用のネジ穴を有すること。 入射角と反射角が同一となるモノスタティックRCS値を校正する。 入射波および反射波の偏波は垂直偏波のみ。
応答非直線性(光パワーメータ)	レーザ波長405 nm、770 nm 帯、850 nm 帯、1 010 nm 帯: 1 nW レベルを基準とした応答非直線性(2 nW レベル以上1 mW レベル以下)	1台1波長20 校正点まで	74,100	1波長を追加する毎に27,100円加算する。 770 nm帯:750 nm以上790 nm以下の範囲で任意に選択可能。 850 nm帯:815 nm以上860 nm以下の範囲で任意に選択可能。 1010 nm帯:960 nm以上1050 nm以下の範囲で任意に選択可能。 空間ビーム系。
	852 nm, 0 dBm (1 mW)を基準とした光パワーメータの指示値[-10 dB,-60 dB]区間における応答非直線性(dB 値)	1台6校正点まで	111,500	光ファイバ系。

	850 nm 帯, -10 dBm (100 $\mu$ W)を基準とした光パワーメータの指示値[-3 dB, -50 dB]区間における応答非直線性(dB 値)	1台1波長24校正点まで	111,500	波長は840 nm以上860 nm以下の範囲で任意に選択可能。 光ファイバ系。
	1 550 nm, 0 dBm (1 mW) を基準とした光パワーメータの指示値[3 dB, 30 dB]区間における応答非直線性(dB 値)	1台10校正点まで	197,400	光ファイバ系。
応答非直線性(アレイ型分光放射計)	レーザー波長405 nm、770 nm 帯、850 nm 帯 アレイ型分光放射計の任意の指示値を基準とした応答非直線性	1台1波長10校正点まで	74,100	1波長を追加する毎に 27,100円加算する。 770 nm帯:750 nm以上790 nm以下の範囲で任意に選択可能。 850 nm帯:815 nm以上860 nm以下の範囲で任意に選択可能。 空間ビーム系。
高周波インピーダンス	2.92 mm同軸(Kコネクタを含む)の終端器、固定減衰器、エアライン、不整合エアライン Sパラメータの大きさ :1 以下 周波数:10 MHz 以上40 GHz 以下/10 MHz 以上90 MHz 以下は10 MHz毎、100 MHz 以上900 MHz 以下は100 MHz 毎、1 GHz 以上40 GHz 以下は0.25 GHz 毎	1個につき	189,900	校正器物を1個追加する毎に131,500円を加算する
	同軸2.92 mm Sパラメータ (Sパラメータの絶対値が1以下、1 GHz~40 GHz で0.25 GHz毎)	1個につき	189,900	校正器物を1個追加する毎に131,500円を加算する
	同軸、Type-N75の終端器、固定減衰器、エアライン、不整合エアライン Sパラメータの大きさ-1以上+1以下 周波数:10 kHz以上 90 kHz以下/10 kHz毎 100 kHz以上900 kHz以下/100 kHz毎 1 MHz以上 9 MHz以下/1 MHz毎 10 MHz以上 30 MHz以下/10 MHz毎、及び9 kHz	1個につき	118,400	校正器物を1点追加する毎に17,100円を加算する。
	同軸、Type-N75の終端器、固定減衰器、エアライン、不整合エアライン Sパラメータの大きさ -1以上+1以下 周波数:0.040 GHz以上0.100 GHz以下/0.010 GHz毎 0.100 GHz以上3.000 GHz以下/0.100 GHz毎 及び0.045 GHzと2.450 GHz	1個につき	163,000	校正器物を1点追加する毎に20,200円を加算する。
	同軸、Type-N75の終端器、固定減衰器、エアライン、不整合エアライン Sパラメータの大きさ-1以上+1以下 周波数:10 kHz以上 90 kHz以下/10 kHz毎 100 kHz以上900 kHz以下/100 kHz毎 1 MHz以上 9 MHz以下/1 MHz毎 10 MHz以上 90 MHz以下/10 MHz毎 0.1 GHz以上3 GHz以下/0.1 GHz毎、及び9 kHz、0.045 GHz、2.45 GHz	1個につき	205,600	校正器物を1点追加する毎に23,000円を加算する。
	導波管 散乱パラメータの大きさ-1~+1 周波数:・10 GHz 毎に110 GHz~ 170 GHz (WR-6,MW-1651 導波管の場合) ・5 GHz 毎に75 GHz~ 110 GHz (WR-10,MW-2540 導波管の場合) ・5 GHz 毎に50 GHz~75 GHz (WR-15 導波管の場合)	1個につき	189,800	校正器物を1点追加する毎に56,600円を加算する。
	レーザーエネルギー	パルスレーザーのエネルギー Nd:YAGレーザー基本波及び高調波である波長355 nm, 532 nm, 1 064 nm の何れかで、エネルギー1 mJ 以上 100 mJ以下の1点、又は波長266 nmで、エネルギー1 mJ以上10 mJ以下の1点	1個1点につき	143,300

	パルスレーザーの平均パワー Nd:YAGレーザー基本波及び高調波である波長355 nm, 532 nm, 1 064 nm の何れ かで、平均パワー10 mW 以上 1 W以下の1点、又は波長266 nmで、平均パワー 10 mW以上100 mW以下の1点	1個1点につき	143,300	波長、エネルギーを1点追加する毎に 10,800円を加算する。 レーザーの繰り返し周波数は10 Hz以 下。
レーザーパワー校正	LDレーザー (1550 nm) , 50 $\mu$ W以上 1 mW以下	1点につき	201,600	1周波数を追加する毎に 23,900円を加算する。
	レーザー波長1.1 $\mu$ m レーザーパワー1 W以上10 W未満	1個1パワーにつ き	198,400	1パワーを追加する毎に46,700円を加算する。
	レーザー波長1.1 $\mu$ m レーザーパワー10 W以上100 W未満	1個1パワーにつ き	275,100	1パワーを追加する毎に112,600円を加算する。
	レーザー波長10.6 $\mu$ m レーザーパワー1 W以上10 W未満	1個1パワーにつ き	196,100	1パワーを追加する毎に57,000円を加算する。
	レーザー波長10.6 $\mu$ m レーザーパワー10 W以上100 W以下	1個1パワーにつ き	229,300	1パワーを追加する毎に71,200円を加算する。
	レーザー波長 405 nm帯 レーザーパワー50 $\mu$ W以上10 mW以下	1個1波長1パ ワーにつき	88,800	1波長、1パワーを追加する毎に13,800 円を加算する。 波長は帯域内で1 nm毎に対応可能。
	レーザー波長 660 nm帯 レーザーパワー50 $\mu$ W以上10 mW以下	1個1波長1パ ワーにつき	88,800	1波長、1パワーを追加する毎に13,800 円を加算する。 波長は帯域内で1 nm毎に対応可能。
	レーザー波長 780 nm帯 レーザーパワー50 $\mu$ W以上10 mW以下	1個1波長1パ ワーにつき	88,800	1波長、1パワーを追加する毎に13,800 円を加算する。 波長は帯域内で1 nm毎に対応可能。
	Arレーザー (488 nm, 515 nm) , 10 mW以上200 mW未満	1点につき	239,500	1周波数を追加する毎に 35,400円を加算する。
	Arレーザー波長488 nm 又は 515 nm レーザーパワー200 mW以上1 W以下	1個1パワーにつ き	113,200	1パワーを追加する毎に、22,800円を加算する。
	He-Neレーザー (633 nm) , 50 $\mu$ W以上10 mW以下	1点につき	199,000	1周波数を追加する毎に、23,600円を加算する。
	レーザー波長640 nm付近, レーザーパワー 100 $\mu$ W	1個につき	282,800	光ファイバ入力形
ビームサイズ(カメラ型レーザービ ームプロファイラ)	ビームサイズ $\phi$ 2 mm レーザー波長0.63 $\mu$ m、1.06 $\mu$ m	1波長につき	286,600	
応答度均一性(ビームプロファ イラ)	レーザー波長0.8 $\mu$ m 露光時間 0.1 ms以上100 ms以下	1個1露光時間 につき	464,800	校正器物は、カメラ型レーザービームプ ロファイラ。 露光時間を1点追加する毎に、59,600 円を加算する。
検出効率(単一光子)	波長1.5 $\mu$ m、単一光子検出器	1個5試験点につ き	186,400	校正器物は、ゲートモード動作の InGaAs-APD を用いた単一光子検出 器。5 試験点を超える場合には、5点 を追加する毎に39,700円。試験点は、 ゲート幅100 ns 以下、かつ、繰り返し 周波数100 MHz 以下。
	波長850 nm、単一光子検出器	1個につき	422,700	校正器物は、Si-APDを用いた単一光 子検出器。
光ファイバ光学長(基準光ファイ バ)	OTDR校正用。 シングルモードファイバ、波長1 310 nmにおいて、2 km 以上 100 km 以下 またはマルチモードファイバ、波長1 300 nmにおいて、1.5 km 以上 5 km 以下	1本1校正点につ き	173,000	

		低周波磁界強度	磁界センサ 0.796 A/m (1.000 $\mu$ T), 1.000 A/m (1.257 $\mu$ T), 3.00 A/m (3.77 $\mu$ T), 3.98 A/m (5.00 $\mu$ T), 7.16 A/m (9.00 $\mu$ T), 7.96 A/m (10.00 $\mu$ T), 10.00 A/m (12.57 $\mu$ T), 23.9 A/m (30.0 $\mu$ T), 30.0 A/m (37.7 $\mu$ T), 39.8 A/m (50.0 $\mu$ T), 79.58 A/m (100.0 $\mu$ T), 100.0 A/m (125.7 $\mu$ T) @ 50 Hz, 60 Hz	1セット(1レベル, 1軸, 50 Hzと60 Hzの2周波数)につき	154,800	1レベルまたは1軸追加する毎に(周波数は50 Hz, 60 Hzのセット) 21,300円加算する。 磁界センサの直径が12cm以下。 磁界センサが複数の軸を有しており表示が分離可能な場合には、指定された軸について校正。センサが複数の軸の合成値としてのみの表示の場合には合成値を校正。 センサ部分と表示部分を個別ではなく、一体として校正される。 通常、磁束密度にて校正を実施する。 磁界強度と磁束密度の変換の際の透磁率を $4\pi \times 10^{-7}$ とする。
			磁界センサ ・0.796 A/m (1.000 $\mu$ T) @ 100 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 60 kHz, 85 kHz, 100 kHz ・2.39 A/m (3.00 $\mu$ T) @ 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 60 kHz ・7.96 A/m (10.00 $\mu$ T) @ 100 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz ・23.9 A/m (30.0 $\mu$ T) @ 100 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz ・79.58 A/m (100.0 $\mu$ T) @ 100 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1 kHz	1点 (1レベル, 1軸)の基本料金	274,700	1校正点(1レベル, 1軸)追加する毎に263,200円加算する。 磁界センサの直径が12cm以下。 磁界センサが複数の軸を有しており表示が分離可能な場合には、指定された軸について校正。センサが複数の軸の合成値としてのみの表示の場合には合成値を校正。 センサ部分と表示部分を個別ではなく、一体として校正される。 通常、磁束密度にて校正を実施する。 磁界強度と磁束密度の変換の際の透磁率を $4\pi \times 10^{-7}$ とする。
		誘電率	誘電体標準試料の比誘電率および誘電正接 周波数は2 GHz付近および23 GHz付近の周波数2点	1試料につき	907,700	比誘電率が1を超え10未満、誘電正接が $10^{-4}$ を超え $10^{-2}$ 未満、試料厚が0.1 mm以上1.5 mm以下。 標準試料片は、直径70mmの円形および直径230 mmの円板試料セットで、試料厚の面内ばらつきが0.01 mm以下であること。
21	測光量・放射量	分光応答度	可視域相対値 波長360 nm以上830 nm以下5 nm毎	1個につき	152,100	
		分光拡散反射率	(可視域) 拡散反射板 波長:360 nm以上830 nm以下、10 nm間隔 反射率:1%以上100%以下	1枚につき	111,700	2枚目以降の校正は、1枚につき78,900円を加算する。
			(紫外域) 拡散反射板 波長:250 nm 以上400 nm 以下、10 nm 間隔 反射率:80%以上	1枚につき	81,400	2枚目以降の校正は、1枚につき33,300円を加算する。
		光度	10 cd以上3 000 cd以下	1個につき	266,400	3個まで1個追加する毎に67,400円を加算する。
		分布温度	2000 K以上3 400 K以下	1個につき	323,600	3個まで1個追加する毎に83,500円を加算する。
		全光束	5 lm以上9 000 lm以下	1個につき	281,300	3個まで1個追加する毎に 58,100円を加算する。
		照度	1 lx以上3 000 lx以下	1個につき	266,400	3個まで1個追加する毎に 67,400円を加算する。
		分光放射照度(紫外、可視、赤外)	ハロゲンランプ(250 nm以上2 500 nm以下)	1個につき	423,400	3個まで1個追加する毎に 272,800円を加算する。

		分光全放射束	波長380 nm以上780 nm以下、5 nm間隔 分光全放射束標準光源(2π分光全放射束標準)	1個につき	478,500	全光束の校正を含む。PID制御機能 つき・温度計測精度±0.03℃以内の 温度コントローラ、および専用ケー ブルを伴うもの。 3個まで1個追加する毎に149,600円を 加算する。
			波長350 nm、355 nm 分光全放射束標準光源(ハロゲン電球24V-150WタイプでE26-E11口金変換ア ダプタを伴うもの)	1個につき	793,600	ハロゲン電球は、十分な枯化、安定性 確認、および再現性確認の実績を有 するもので、規定の口金アダプタを装 着のこと。 3個まで1個追加する毎に285,900円を 加算する。
		BRDF(2方向反射率分布関 数)	(可視域) 拡散反射板 波長:360 nm 以上830 nm 以下、10 nm 間隔 反射率:80%以上 幾何条件:0°入射, 45°受光	1枚につき	145,900	2枚目以降の校正は、1枚につき 57,100円を加算する。 (最大3枚まで) BRDFの校正値に加え、分光放射輝 度率の値も報告する。
		全放射束	中心波長365 nm, 385 nm 近傍の紫外LED	1個につき	215,000	器物1個追加毎に116,500円を加算 する。(最大3個まで)
		分光透過率	標準NDフィルタ 波長:380 nm以上1000 nm以下 透過率:0.1%以上100%未満	基本測定点 (波長または 校正器物:30 点)につき	481,800	測定点を1点追加ごとに13,700円を加 算する。(最大30測定点の追加まで)
22	放射線	照射線量(率)測定器	中硬X線照射装置を用いた照射線量(率)・線量当量(率)校正	1台1校正点に つき	172,500	校正点を1点追加する毎に55,900円を 加算する。
			軟X線照射装置を用いた照射線量(率)校正・線量当量(率)校正	1台1校正点に つき	155,100	1点を追加する毎に46,000円を加算 する。
			大線量γ線照射装置を用いた照射線量(率)・線量当量(率)校正	1台1校正点に つき	125,700	校正点を1点追加する毎に33,900円を 加算する。
			小線量γ線照射装置を用いた照射線量(率)・線量当量(率)校正	1台1校正点に つき	121,400	校正点を1点追加する毎に29,200円を 加算する。
		放射線量検出素子	中硬X線照射装置を用いた照射線量・線量当量照射	1回照射につ き	144,500	1照射を追加する毎に27,900円を加算 する。
			軟X線照射装置を用いた照射線量照射・線量当量照射	1回照射につ き	132,300	1点を追加する毎に22,700円を加算す る。
			大線量γ線照射装置を用いた照射線量・線量当量照射	1回照射につ き	103,900	1照射を追加する毎に15,300円を加算 する。
			小線量γ線照射装置を用いた照射線量・線量当量照射	1回照射につ き	101,700	1照射を追加する毎に13,400円を加算 する。
		Co-60 γ線水吸収線量	水吸収線量率測定器 水吸収線量測定器 水吸収線量検出素子	1台1校正点ま たは1試験点 につき	149,300	1校正点または1試験点を追加する毎 に33,900円を加算する。
				1台1校正点ま たは1試験点 につき	112,000	大線量γ線の照射線量校正と同時依 頼の場合。1校正点または1試験点を 追加する毎に33,900円を加算する。
23	放射能	環境レベル放射能	放射能試料(γ線放出核種)	1個につき	77,200	
25	温度	貴金属熱電対	亜鉛点	1個につき	337,400	
			アルミニウム点	1個につき	337,600	
			銀点	1個につき	290,900	
			銅点	1個につき	291,100	
			コバルト - カーボン共晶点	1個につき	333,900	



			1個につき	350,000	純金属のもの
	パラジウム点		1個につき	350,100	
	ロジウム - カーボン共晶点		1個につき	2,571,000	
	0 °C 以上 1100 °C 以下		1個につき	872,900	
卑金属熱電対	ルテニウム-カーボン共晶点		1 個につき	1,761,400	
白金抵抗温度計	インジウム点	不確かさ 0.40 mK	1個につき	638,100	
		不確かさ 1.8 mK	1個につき	242,100	
	スズ点	不確かさ 0.6 mK	1個につき	688,800	
		不確かさ 1.8 mK	1個につき	395,400	
	亜鉛点	不確かさ 0.7 mK	1個につき	688,800	
		不確かさ 2.0 mK	1個につき	395,400	
	水の三重点(標準抵抗器を伴う)		1個につき	125,600	
	水銀点		1個につき	282,200	
	アルミニウム点	不確かさ 1.8 mK	1個につき	718,000	
		不確かさ 3.5 mK	1個につき	383,200	
	銀点		1個につき	446,000	
	ガリウム点	不確かさ 0.20 mK	1個につき	777,600	
		不確かさ 0.6 mK	1個につき	340,200	
	77 K以上173 K以下		1個1温度点につき	508,900	1指定温度点追加毎に352,900円加算する。但し、温度点としてアルゴン点(83.8058 K)は除く。
	範囲 0.01 °C以上156.5985 °C以下		1個につき	267,000	
	範囲 0.01 °C以上231.928 °C以下		1個につき	673,600	
	範囲 0.01 °C以上419.527 °C以下		1個につき	826,900	
範囲 0.01 °C以上660.323 °C以下		1個につき	1,158,300		
範囲 0.01 °C以上961.78 °C以下		1個につき	1,516,800		
抵抗温度計用定点装置	水の三重点セル	不確かさ 0.10 mK	1個につき	1,031,100	
		不確かさ 0.16 mK	1個につき	336,900	

	ガリウム点セル	不確かさ 0.18 mK	1個につき	1,042,300	
		不確かさ 0.45 mK	1個につき	371,900	
非接触温度計・校正装置	定点黒体	銅点	1個につき	311,600	
		銀点	1個につき	305,300	
		アルミニウム点	1個につき	299,800	
		亜鉛点	1個につき	292,900	
	定点黒体(インジウム、スズ)		1個1定点温度につき	157,800	2個を同時申請する場合(異なる定点温度を含む)のみ、2個目の料金は103,400円とする。
	放射温度計	0.9 μm放射温度計(400℃～1085℃、特定式の定数付けを含む)	1個5点まで	356,900	基本料金が5点までのもので、試験温度6点以上は1点を追加する毎に35,200円を加算する。
		1.6 μm放射温度計(160℃～960℃、定点校正による目盛設定、特性式の定数付けを含む)	1個5点まで	493,700	不確かさ評価温度が6点以上は1点を追加する毎に50,800円を加算する。
	比較黒体炉	35℃以上 42℃以下のもの	1個1点につき	164,000	1測定点を追加する毎に81,500円を加算する(最大3点までとする。耳用赤外線体温計用の黒体炉に限る)。
		100℃以上 160℃以下のもの	1個1点につき	191,900	1測定点を追加する毎に93,500円を加算する(最大4点までとする)。
		-30℃以上100℃以下のもの	1個1点につき	193,400	1測定点を追加する毎に90,000円を加算する(最大8点までとする)。
定点黒体セル	炭化タングステン - 炭素包晶点(2748℃)	1個につき	365,800	定点黒体セル1個を追加する毎に181,500円を加算する。	
	レニウム - カーボン共晶点(2474℃)				
	白金 - カーボン共晶点(1738℃)				
	パラジウム - カーボン共晶点(1492℃)				
	コバルト - カーボン共晶点(1324℃)				

		低温抵抗温度計・比較校正	0.65 K 以上24.5561 K以下 (6 K 以上24 K 以下で1 K 毎の19 校正点)	1本(19校正点を含む。)につき	896,000	追加する校正点が6 K以上の場合、1校正点を追加する毎に37,400円を加算する。 追加する校正点が6 K 未満の場合、最初の1校正点の追加で240,000円を、2 校正点以降は、1校正点を追加する毎に51,700円を加算する。 【同時に2本を校正する場合】 273,700円を加算する。 追加する校正点が6 K以上の場合、2校正点(1温度)を追加する毎に45,200円を加算する。 追加する校正点が6 K未満の場合、最初の2校正点(1温度)の追加で252,500 円を、4校正点(2温度)以降は、2校正点(1温度)を追加する毎に64,300円を加算する。 【同時に3本を校正する場合】 547,500円を加算する。 追加する校正点が6 K 以上の場合、3校正点(1温度)を追加する毎に57,700円を加算する。 追加する校正点が6 K未満の場合、最初の3校正点(1温度)の追加で265,000 円を、6校正点(2温度)以降は、3校正点(1温度)を追加する毎に76,800円を加算する。
		カプセル型白金抵抗温度計	84 K以上273 K以下	1個1本につき	565,100	校正器物は3本まで同時校正が可能。同時に校正する場合は、1本追加につき486,400円を加算する。
	54 K以上273 K以下		1個1本につき	680,700	校正器物は、3本まで同時校正が可能。同時に校正する場合は、1本追加につき389,400円を加算する。	
	24 K以上273 K以下		1個1本につき	911,000	校正器物は、3本まで同時校正が可能。同時に校正する場合は、1本追加につき372,400円を加算する。	
	14 K以上273 K以下		1個1本につき	1,193,200	校正器物は、3本まで同時校正が可能。同時に校正する場合は、1本追加につき557,000円を加算する。	
	Ga点		1個1本につき	260,100		
26	湿度	露点計	露点範囲：-10 °C以上+85 °C以下	1個1点につき	171,900	1測定点を追加する毎に50,600円を加算する(追加は最大7測定点まで)。
		相対湿度計	温度23 °Cにおいて相対湿度:10 %以上95 %以下	1個1校正点につき	174,300	1校正点を追加する毎に51,400円を加算する。
27	熱物性	熱膨張率(線膨張係数) 標準物質生産にかかる熱膨張率校正	20 mm×20 mm× 8 mmの固体ブロック 校正温度範囲: 15 K以上320 K以下 測定時間:240時間	1個(校正点49点を含む)につき	403,800	測定時間を1時間追加する毎に2,800円を加算する。 測定時間を1時間削減する毎に2,900円を減算する。
		熱膨張率(線膨張係数)	試験対象物質:JIS B7506 で定めるブロックゲージと同等な形状精度をもつ固体試験片 呼び寸法の範囲:100 mm 測定温度範囲:-20 °C以上60 °C以下	1校正点につき	186,600	1校正点を追加する毎に72,700円を加算する。
28	硬さ	ロックウェル硬さ標準片	Cスケール	3個まで	93,700	
		ビッカース硬さ標準片		3個まで	132,800	

		ブリネル硬さ標準片	範囲 200 HBW 以上 500 HBW 以下 (ノミナル) 50 HBW 間隔 硬さスケール 2.5/187.5 以上	同一スケール 3個まで	117,400	
33	濃度	標準液	かび臭物質2種混合標準液の濃度測定(20 °Cにおける質量濃度として90 mg/L 以上110 mg/L以下)	1試料につき	341,600	メタノール希釈のものであって、ジェオ スミン及び2-メチルイソボルネオール の各濃度が試験・校正の細目の範囲 のもの 分析対象成分及び希釈溶媒以外の有 機化合物の総濃度が20 °Cにおける 質量濃度として10 mg/Lを超えないこ と
			ハロ酢酸4種混合標準液の濃度測定(質量分率として1 200 mg/kg以上1 500 mg/kg以下)	1試料につき	272,100	t-ブチルメチルエーテル希釈のもので あって、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリ クロロ酢酸及びプロモ酢酸の各濃度が 試験・校正の細目の範囲のもの 分析対象成分及び希釈溶媒以外の有 機化合物の総濃度が質量分率として 100 mg/kgを超えないこと
			フェノール類6種混合標準液の濃度測定(質量分率として1 100 mg/kg以上1 400 mg/kg以下)	1試料につき	311,800	アセトン希釈のものであって、フェノール、 2-クロロフェノール、4-クロロフェノ ール、2,4-ジクロロフェノール、2,6-ジ クロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフ ェノールの各濃度が試験・校正の細目 の範囲のもの 分析対象成分及び希釈溶媒以外の有 機化合物の総濃度が質量分率として 100 mg/kgを超えないこと
			ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル標準液の濃度測定(質量分率として110 mg/kg以上140 mg/kg以下)	1試料につき	305,300	・メタノール希釈のものであって、ヘプ タオキシエチレンドデシルエーテルの 濃度が試験・校正の細目の範囲のも の ・分析対象成分及び希釈溶媒以外の 有機化合物の総濃度が質量分率とし て10 mg/kgを超えないこと
			滴定法による単元素標準液または単成分非金属イオン標準液の濃度測定(質量 分率として800 mg/kg以上1 200 mg/kg以下。ただし、臭素酸イオンについては1 600 mg/kg以上2 400 mg/kg以下)	1試料につき	105,400	・NMIJ CRM等を原料物質として、特定 標準物質と同じ製造装置および手順 で調製した標準液であること ・分析対象成分以外の不純物の総濃 度が質量分率として100 µg/kgを超え ないこと
			イオンクロマトグラフィーによる単元素標準液または単成分非金属イオン標準液の 濃度測定(質量分率として800 mg/kg以上1 200 mg/kg以下)	1試料につき	105,100	・NMIJ CRM等を原料物質として、特定 標準物質と同じ製造装置および手順 で調製した標準液であること ・分析対象成分以外の不純物の総濃 度が質量分率として100 µg/kgを超え ないこと
52	その他	家庭用はかり	ひょう量が50 kgを超え200 kg以下の一般用体重計 器差:試験点はひょう量の約25%, 約50%, 約75%及びひょう量付近の4点 零復帰度(変化量)を含む	1個につき	11,300	零復帰度は零点表示するものに限る。
			ひょう量が3 kg以下の調理用はかり 器差:試験点はひょう量の約25%, 約50%, 約75%の3質量点(加・減)及びひょ う量付近の7点 零復帰度(変化量)を含む	1個につき	10,100	
		非自動はかり(3級, 4級)	ひょう量が50 kg以下の非自動はかり(目量の1/5以下の拡張表示装置を有するも の) 器差試験:試験点は最小測定量付近を含む指定する4質量点(増・減)及び最 大能力付近の9試験点 感じ、繰返し性、偏置荷重、正味量、風袋計量装置、半自動零点設定装置又は 非自動零点設定装置、風袋引き装置を含む	1個につき	9,300	1計量範囲において、1質量点(増・ 減)を追加する毎に 700円を加算す る。 複目量はかりにおいて、1計量範囲を 追加する毎に 8,200円を加算する。

		<p>ひょう量が50 kg以下の非自動はかり(目量の1/5以下の拡張表示装置を有しないもの)  器差試験:試験点は最小測定量付近を含む指定する4質量点(増・減)及び最大能力付近の9試験点  感じ、繰返し性、偏置荷重、正味量、風袋計量装置、半自動零点設定装置又は非自動零点設定装置、風袋引き装置を含む</p>	1個につき	16,800	1計量範囲において、1質量点(増・減)を追加する毎に 1,700円を加算する。 複目量はかりにおいて、1計量範囲を追加する毎に 15,700円を加算する。
		<p>ひょう量が50 kgを超え200 kg以下の非自動はかり(目量の1/5以下の拡張表示装置を有するもの)  器差試験:試験点は最小測定量付近を含む指定する4質量点(増・減)及び最大能力付近の9試験点  感じ、繰返し性、偏置荷重、正味量、風袋計量装置、半自動零点設定装置又は非自動零点設定装置、風袋引き装置を含む</p>	1個につき	10,000	1計量範囲において、1質量点(増・減)を追加する毎に 800円を加算する。 複目量はかりにおいて、1計量範囲を追加する毎に 8,900円を加算する。
		<p>ひょう量が50 kgを超え200 kg以下の非自動はかり(目量の1/5以下の拡張表示装置を有しないもの)  器差試験:試験点は最小測定量付近を含む指定する4質量点(増・減)及び最大能力付近の9試験点  感じ、繰返し性、偏置荷重、正味量、風袋計量装置、半自動零点設定装置又は非自動零点設定装置、風袋引き装置を含む</p>	1個につき	18,800	1計量範囲において、1質量点(増・減)を追加する毎に 1,900円を加算する。 複目量はかりにおいて、1計量範囲を追加する毎に 18,300円を加算する。
	抵抗体温計	抵抗体温計 3試験温度	同一試験温度 3個につき	16,800	同一型式の試験器物(試験温度点と同じ場合に限る)を1個追加することに7,400円を加算。但し追加は2個まで
	アネロイド型血圧計	電気式アネロイド型血圧計 試験点は50 mmHg～250 mmHgの範囲で50 mmHg 毎の5圧力点(加圧・減圧)及び最大圧力の11点	1個につき	8,500	

別表2-3 計量の標準に係る校正、試験等  
(特定副標準器)

No.	種類	項目	細目	手数料(基本料金)(円)		備考
19	直流・低周波		ジョセフソン効果電圧測定装置		0	
			電圧発生装置		0	
			電圧測定装置		0	
			標準分圧器		0	
			標準抵抗器		0	
			抵抗測定装置		0	
			交流電圧用交直変換器		0	
			交流電流用交直変換器		0	
			交直差測定装置		0	
21	測光量・放射量		コイルM字型光度標準電球		0	
			全光束標準電球		0	
			単平面型照度標準電球		0	
			分光放射照度標準電球		0	
			コイルM字型分布温度標準電球		0	
25	温度	温度計用	水の三重点実現装置		0	
			インジウム点実現装置		0	
			水銀点実現装置		0	
			スズ点実現装置		0	
			亜鉛点実現装置		0	
		放射温度計校正用	亜鉛点実現装置		0	
			アルミニウム点実現装置		0	
			銀点実現装置		0	
			銅点実現装置		0	
			単色放射温度計		0	

別表 3 (直接経費の詳細)

<p>人件費</p>	<p>[計算式] 人件費 = <math>A \div B \div C \times \alpha</math></p> <p>A 研究職員の人件費総額</p> <p>B 研究職員総数</p> <p>C 研究職員延勤務時間数。ただし、年間勤務時間数は、全研究職員 1 人当たり 2015 時間 (1 日 7 時間 45 分、1 週 5 日間、1 年 52 週間) とする。</p> <p><math>\alpha</math> 当該試験・分析等に従事する研究職員の稼働時間数。ただし、稼働時間数は、試験・分析等の事前の準備・調整及び事後の整理・整備等が必要な場合にはそれらに要する時間を含めるが、直接に操作する必要がなく、人手を要しない単なる待機時間 (自動運転時間) 等を含めない。</p>
<p>消耗品費</p>	<p>各消耗品 (研究用薬品類、理化学用品類及び部品・器具・工具類等) の価格 (以下「各消耗品費」という。) の合計額とする。</p> <p>[計算式] 各消耗品費 = 各消耗品費の単価 <math>\times</math> 当該試験・分析等の実施に要する使用数量</p>
<p>光熱水料</p>	<p>光熱水料は、電力料、ガス料及び水道料の合計額とする。</p> <p>[計算式] 光熱水料 = 電力料 + ガス料 + 水道料</p> <p>(1) 電力料は、当該試験・分析等を実施する研究部門が所在する地域センターにおける単価を用いて、次の計算式により算定した額とする。</p> <p>[計算式] 電力料 = <math>D \div E \times \beta</math></p> <p>D 当該地域センターにおける電力料金総支払額。</p> <p>E 当該地域センターにおける電力総使用量。</p> <p><math>\beta</math> 当該試験・分析等の実施に要する使用量。ただし、使用量は、事前の準備及び調整並びに事後の整理及び整備等が必要な場合は、それらに要する使用量を含める。</p> <p>(2) ガス料は、当該試験・分析等を実施する研究部門が所在する地域センターにおける単価を用いて、次の計算式により算定した額とする。</p> <p>[計算式] ガス料 = <math>F \div G \times \gamma</math></p> <p>F 当該地域センターにおけるガス料金総支払額。</p> <p>G 当該地域センターにおけるガス総使用量。</p> <p><math>\gamma</math> 当該試験・分析等の実施に要する使用量。ただし、使用量は、事前の準備及び調整並びに事後の整理及び整備等が必要な場合は、それらに要する使用量を含める。</p> <p>(3) 水道料は、当該試験・分析等を実施する研究部門が所在する地域センターにおける単価を用いて、次の計算式により算定した額とする。</p> <p>[計算式] 水道料 = <math>H \div J \times \delta</math></p> <p>H 当該地域センターにおける水道料金総支払額。</p> <p>J 当該地域センターにおける水道総使用量。</p> <p><math>\delta</math> 当該試験・分析等の実施に要する使用量。ただし、使用量は、事</p>

	<p>前の準備及び調整並びに事後の整理及び整備等が必要な場合は、それらに要する使用量を含める。</p>
設備費	<p>当該試験・分析等の実施に使用する機械器具装置類に係る維持費の合計額とする</p> <p>[計算式] 維持費 = <math>(K - K \times a) \div L \times (\varepsilon + \lambda)</math></p> <p>K 取得価格。取得価格は、取得当初における購入価格とする。ただし、改造等により増減がある場合は、それらの増減価格を含める。</p> <p>L 耐用年数。耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)における耐用年数を参考とする。</p> <p>a 残存割合。残存割合は、原則として、省令別表第10に掲げる残存割合。</p> <p><math>\varepsilon</math> 当該試験・分析等の実施に要する使用時間数又は使用回数。ただし、使用時間数又は使用回数は、事前の準備及び調整並びに事後の整理及び整備等が必要な場合は、それらに要する使用時間数又は使用回数を含める。</p> <p><math>\lambda</math> 1年間の全使用時間数又は全使用回数</p>



別表4

1	NMIJ 若しくは NMIJ と相互承認を結んだ発行機関が発行した OIML 適合証明書、 又は NMIJ が発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合
2	遠隔校正